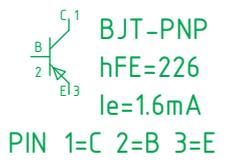
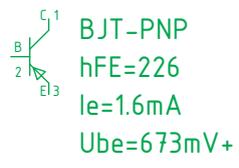
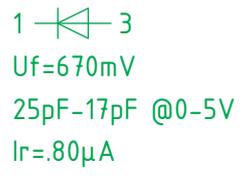


Leitfaden  
zum Hiland 644  
Instrument zum identifizieren und messen  
von elektronischen Bauteilen und  
elektrischen Einheiten

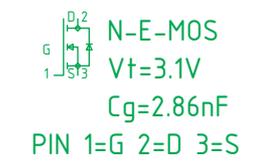
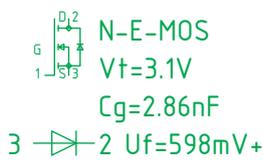
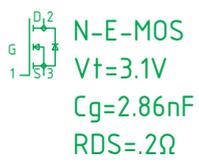
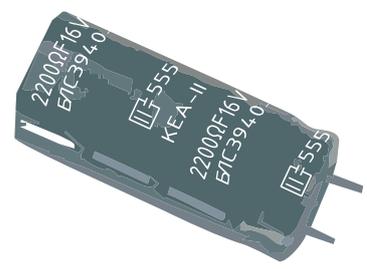
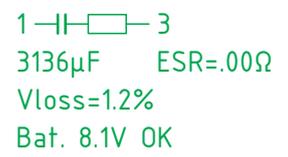
Version 1.13k  
aber auch  
1.39m



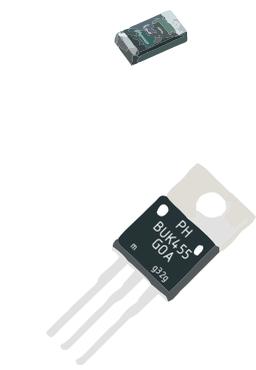
Karl-Heinz Kübbeler  
kh\_kuebbeler@web.de  
&  
Markus Reschke  
madies@theca-tabellaria.de



Zusammengestellt  
von bm-magic  
©  
29. Mai 2020



15.05.2019/MOR



---

## *Inhaltsverzeichnis*

---

<b>1</b>	<b>Vorwort</b>	<b>4</b>
1.1	Software für den Tester . . . . .	4
1.2	Lizenz . . . . .	4
1.2.1	Zusätzliche HinweiseLizenz . . . . .	4
1.3	Sicherheitshinweise . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Hardware</b>	<b>5</b>
2.1	Beschreibung . . . . .	5
2.2	Die Bedienung . . . . .	6
2.2.1	Taster . . . . .	6
2.2.2	Impulsdrehgeber . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Eigenschaften</b>	<b>7</b>
3.1	Automatische Bauteile Bestimmung . . . . .	7
3.1.1	Auswahlmenü . . . . .	9
3.2	Wichtige Bemerkungen . . . . .	9
3.3	Problemfälle . . . . .	9
3.4	Bedienungssprachen . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Funktionsmenü in der k-Version</b>	<b>11</b>
4.0.1	Einzelmessung . . . . .	11
4.0.2	Dauermessung . . . . .	11
4.0.3	Serienmessung . . . . .	11
4.1	Optionale Menüfunktionen . . . . .	11
4.1.1	Frequenz . . . . .	12
4.1.2	f-Generator . . . . .	12
4.1.3	10-bit PWM . . . . .	12
4.1.4	C+ESR@TP1:3 . . . . .	12
4.1.5	Widerstandsmeßgerät . . . . .	12
4.1.6	Kondensatormeßgerät . . . . .	13
4.1.7	Impulsdrehgeber . . . . .	13
4.1.8	C( $\mu F$ )-Korrektur . . . . .	13
4.1.9	Selbsttest . . . . .	13
4.1.10	Spannung . . . . .	13
4.1.11	Kontrast . . . . .	14
4.1.12	Zeige Daten . . . . .	14
4.1.13	Schalte aus . . . . .	14
4.1.14	Transistor . . . . .	14
4.2	Selbsttest und Kalibration . . . . .	14

<b>5</b>	<b>Funktionsmenü in der m-Version</b>	<b>16</b>
5.0.1	Bauteilesuche . . . . .	16
5.0.2	Batterieüberwachung . . . . .	16
5.0.3	Ausschalten . . . . .	17
5.1	Menü . . . . .	17
5.1.1	PWM-Generator . . . . .	17
5.1.2	Einfache PWM . . . . .	17
5.1.3	Erweiterte PWM . . . . .	17
5.1.4	Rechteck-Signalgenerator . . . . .	17
5.1.5	Voltmeter und Zenertest . . . . .	18
5.1.6	ESR-Messung . . . . .	18
5.1.7	Kondensatorleckstrom . . . . .	18
5.1.8	R/L-Monitor . . . . .	18
5.1.9	C-Monitor . . . . .	18
5.1.10	Frequenzzähler . . . . .	19
5.1.11	Einfacher Zähler . . . . .	19
5.1.12	Erweiterter Zähler . . . . .	19
5.1.13	Ereigniszähler . . . . .	19
5.1.14	Drehencoder . . . . .	20
5.1.15	Kontrast . . . . .	20
5.1.16	Detektor/Decoder für IR-Fernbedienungen . . . . .	20
5.1.17	IR-Fernbedienung . . . . .	21
5.1.18	Opto-Koppler-Test . . . . .	22
5.1.19	Modellbau-Servo-Test . . . . .	23
5.1.20	OneWire-Scan . . . . .	23
5.1.21	Temperatursensor DS18B20 . . . . .	23
5.1.22	DHTxx-Sensoren . . . . .	24
5.1.23	Selbsttest . . . . .	24
5.1.24	Selbstabgleich . . . . .	25
5.1.25	Speichern/Laden . . . . .	25
5.1.26	Werte anzeigen . . . . .	26
5.1.27	Font . . . . .	26
5.1.28	Ausschalten . . . . .	26
5.1.29	Exit . . . . .	26
<b>6</b>	<b>Programm Code</b>	<b>27</b>
6.1	In der k-Version . . . . .	27
6.2	In der m-Version . . . . .	27
6.3	Makefile . . . . .	27
6.3.1	MCU-Typ . . . . .	27
6.3.2	MCU-Taktfrequenz . . . . .	27
6.3.3	Oszillator-Typ . . . . .	28
6.3.4	Avrdude MCU-Typ . . . . .	28
6.3.5	Avrdude ISP-Programmierer . . . . .	28
6.4	config.h . . . . .	28
6.4.1	Für diesen Tester muss geändert werden: . . . . .	28
6.5	Config_644.h . . . . .	31
6.5.1	Notwendige Änderungen . . . . .	31
6.5.2	Bemerkung . . . . .	32
<b>7</b>	<b>Programmieren des Testers</b>	<b>33</b>
7.1	Konfigurieren des Testers . . . . .	33
7.2	Programmierung des Mikrocontrollers . . . . .	33
7.2.1	Betrieb System Linux . . . . .	33
7.2.2	Benutzung unter Linux . . . . .	34

7.2.3	Programm Pakete installieren . . . . .	34
7.2.4	Download der Quellen . . . . .	34
7.2.5	Benutzung der Schnittstellen . . . . .	34
7.2.6	Gruppen Mitgliedschaft . . . . .	35
7.2.7	Arbeitsumgebung . . . . .	35
7.2.8	Arbeitsumgebung mit der k-Version . . . . .	36
7.3	Nötige Hardware zum Programmieren . . . . .	37
7.3.1	Programmer . . . . .	37
7.3.2	Kauf Möglichkeit . . . . .	37
7.4	Hiland Schaltung mit ATmega644 . . . . .	38
7.5	Technische Daten . . . . .	39
7.6	Hilfe . . . . .	39

Jeder Bastler kennt das folgende Problem: Man baut einen Transistor aus oder man nimmt einen aus einer Bastelkiste. Wenn man die Typenbezeichnung erkennen kann und man bereits ein Datenblatt hat oder eins bekommen kann, ist alles in Ordnung. Aber wenn man keine Datenblätter findet, hat man keine Idee, was das für ein Bauteil sein kann. Mit den konventionellen Messmethoden ist es schwierig und zeitaufwändig den Typ des Bauteils und dessen Parameter herauszufinden. Es könnte ein NPN, PNP, N- oder P-Kanal-MOSFET usw. sein. Es war die Idee von Markus F., diese Arbeit von einem AVR-Mikrocontroller erledigen zu lassen.

vorhergehende Sätze...sind abgeschrieben aus der Transistor Tester Einleitung von Karl-Heinz Kübbeler. Eigentlich stammt ein großer Teil dieses Dokuments aus Auszügen seiner Arbeit, ...bei dem ich mich hiermit bedanken möchte ...

### 1.1. Software für den Tester

basiert auf dem Projekt von Markus Frejek [1] und der Weiterführung von Karl-Heinz Kübbeler [2] und Markus Reschke [3].

Während die Firmware von Karl-Heinz die offizielle Version ist und auch ältere ATmega MCUs unterstützt, dient die Firmware von Markus zum Ausprobieren und Testen neuer Ideen und bietet einige Änderungen der Benutzerschnittstelle und Mess- und Testverfahren. Außerdem ist sie auf ATmegas mit mindestens 32kB Flash beschränkt.

...auch diesem Entwickler möchte ich, hiermit danken...

**Spezifikation** Beide Versionen sind für den Einsatz in verschiedenen Testern mit unterschiedlicher Hardware konzipiert und müssen deswegen konfiguriert werden. Beide Entwickler benutzen ihre eigene Methoden. Um dies zu erleichtern wurde dieses Leitfadens geschrieben.

### 1.2. Lizenz

Der Autor der Ursprungsversion hat bzgl. der Lizenzbedingungen nur zwei Vorgaben gemacht. Zum einen ist das Projekt Open Source, und zum anderen sollen sich kommerzielle Benutzer beim Autor melden.

Unglücklicherweise haben beide Entwickler den Autor bisher nicht erreichen können. Um das Problem des Fehlens einer vernünftigen Open-Source-Lizenz zu lösen, wurde am 1.1.2016 eine Standard-Open-Source-Lizenz ausgewählt, nachdem der ursprüngliche Autor ausreichend Zeit hatte uns seine Wünsche bzgl. einer Lizenz mitzuteilen.

Da diese Firmwareversion eine komplett neue Version ist, die lediglich ein paar Ideen der ursprünglichen Firmware aufgreift, aber keinen Code teilt, sollte dieses Vorgehen gerechtfertigt sein.

Lizenziert unter der EUPL V.1.1

#### 1.2.1. Zusätzliche HinweiseLizenz

Produkt- oder Firmennamen können geschützte Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

### 1.3. Sicherheitshinweise

Der Component Tester ist kein Multimeter!

Es ist ein einfacher Tester für Bauteile, der Verschiedenes messen kann.

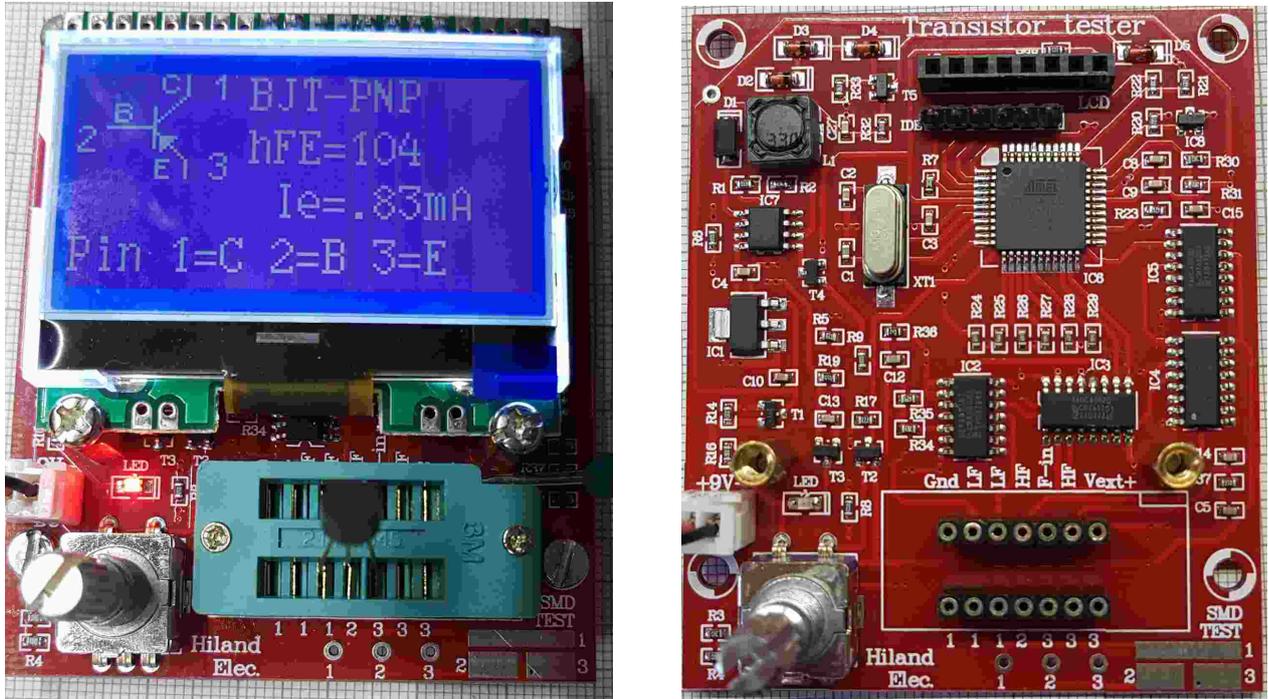
Die Eingänge sind nicht geschützt und werden durch Spannungen über 5V beschädigt.

Den Tester nicht für Schaltungen in Betrieb nutzen, sondern nur für einzelne Bauteile!

Bei Kondensatoren darauf achten, dass sie entladen sind, bevor der Tester angeklemt wird.

Benutzung auf eigene Gefahr!

2.1. Beschreibung



(a) unten TP1 bis TP3 für Bauteilebestimmung

(b) oben Pins für Auswahlmenü und die IDE

Abbildung 2.1. Hiland Tester mit Testsockel und 128x64 Pixel Display

Die Testports **TP1**, **TP2** und **TP3** werden für die Bauteilerkennung benutzt und sind auf der Platine mit den Ziffern **1,1,1; 2; 3,3,3** gekennzeichnet.

Die gleiche Bezeichnung befindet sich auf dem SMD Testfeld und es besteht auch eine Möglichkeit, eigene Test Kabel anzulöten.

- Der **Testport TP2** wird auch für die Ausgabe der Sonderfunktion „f-Generator“ benutzt.
- Die mit **LF** bezeichneten Pins sind für die Messung von Quarzen mit niedriger Resonanzfrequenz vorgesehen, und die mit **HF** sind für Quarze mit hoher Resonanzfrequenz.
- Der Pin **F-in** wird zusammen mit **Gnd** für die Sonderfunktion Frequenz benutzt.
- Der Pin **Vext+** wird ebenso zusammen mit **Gnd** für die Spannungsmessung und die Zenerdiodenmessung benutzt.

Unten dem Display befindet sich die IDE Schnittstelle, die folgend belegt ist:  
**von links nach rechts:** 1 -Reset; 2 -SCK; 3 -MISO; 4 -MOSI; 5 -+5V; 6 -GND.

- Der Tester verwendet einen ATmega 644PA und ist mit 8 MHz Quarz bestückt.
- Bildschirm wurde mit grafischem LCD Display ST7565 mit 128 x 64 Pixel realisiert, was, wie man auf dem Bild sieht vier, leicht lesbare, Zeilen bedeutet oder aber auch acht gut lesbarer Zeilen in der Standart m-Version. Der Kontrast ist in beider Versionen per Menü einstellbar.
- Energie erhält es von eine 9V E-Block Batterie.
- Auf der Platine ist ein DC-DC-Konverter. Damit sind Z-Dioden bis 50V bestimmbar.
- Ebenso ist ein 16:1 Frequenzteiler vorhanden.

## 2.2. Die Bedienung

ist realisiert durch einen Impulsdrehgeber mit Drucktaster und ist relativ einfach. Trotzdem sind einige Hinweise erforderlich.

Für Bauteile Bestimmung ist die **untere** Reihe des Sockels und das SMD Testfeld zuständig. **Bauteile mit drei Anschlüssen** sollen mit den von 1 bis 3 beschrifteten Pins in beliebiger Reihenfolge verbunden werden.

**Zweipolige Bauteile** werden an zwei Pins mit unterschiedlichen Zahlen angeschlossen.

**Die Polarität** spielt keine Rolle, auch Elektrolyt Kondensatoren können beliebig angeschlossen werden. Die Messung der Kapazität wird aber so durchgeführt, dass der Minuspol am Testport mit der kleineren Nummer liegt. Da die Messspannung aber zwischen 0,3V und maximal 1,3V liegt, spielt auch hier die Polarität keine wichtige Rolle.

Wenn das Bauteil angeschlossen ist, sollte es während der Messung nicht berührt werden. Lege es auf einen isolierenden Untergrund ab, wenn es nicht in einem Sockel steckt. Berühre auch nicht die Isolation der Messkabel, das Messergebnis kann beeinflusst werden.

Nun sollte der Starttaster **kurz** gedrückt werden.

**Was hier geschieht, hängt von der Softwarekonfiguration ab.**

Damit ein Vergleich möglich ist wurden hier gleiche Konfigurationen und Zeiten benutzt.

**2.2.1. Taster schaltet den Tester ein** und dient zur **Bedienung**. Im automatischem Modus wartet Tester 30 Sec auf ein Bauteil ... bevor ... für die Batterie Schonung, abschaltet. Falls ist, in dieser Zeit, ein Bauteil eingelegt ist, benehmen sich die Versionen **unterschiedlich**. **In der m-Version** schaltet Tester konsequent nach 30 Sec ab aber du kannst durch längerer Druck früher beenden.

- Eine neue Messung erreichst du mit einem kurzem Druck oder durch drehen des Enkoders nach rechts.
- Und das Auswahlmenü durch Doppeldruck oder durch drehen nach links.

Tester unterscheidet zwischen:

1. **kurzen Tastendruck**, der üblicherweise zum Fortfahren einer Funktion oder zur Auswahl des nächsten Menüpunktes benutzt wird,
2. **langen Tastendruck** (> 0,3s), der eine kontextabhängige Aktion ausführt und
3. **Doppelklick** der die Aktion beendet.

Wenn der Tester einen Tastendruck zum Fortfahren der aktuellen Aktion erwartet, zeigt es dies durch einen Cursor rechts unten auf dem LCD-Modul an.

Ein statischer Cursor signalisiert, dass weitere Informationen folgen, und ein blinkender Cursor bedeutet, dass mit der Bauteilesuche weiter gemacht wird.

Für einige Funktionen wird der Cursor nicht angezeigt, da die erwartete Eingabe klar sein sollte. **In der k-Version** schaltet der Tester **nicht aus**, sondern wartet auf den nächsten Bauteil, denn dann automatisch testet.

Zum ausschalten ist ein Tastendruck oder schnelles drehen, in beliebigen Richtung, nötig.  
- Auswahlmenü erreichst nach dem einschalten **ohne** eines eingelegten Bauteils durch ein langes Druck (> 0.5s) oder durch ein schnelles drehen des Drehencoders.

**2.2.2. Impulsdrehgeber** verleiht dem Tester zusätzliche Funktionalität, die kontextabhängig ist. Manche Funktionen erlauben über die Drehgeschwindigkeit größere Änderungen oder Sprünge von Werten. Der Lese-Algorithmus berücksichtigt die Anzahl der Gray-Code-Pulse pro Schritt und auch die Anzahl der Schritte für eine volle 360° Umdrehung. Die Erkennung der Drehgeschwindigkeit misst die Zeit von zwei Schritten.

Also solltest Du den Drehgeber mindestens um zwei Schritte für mittlere Geschwindigkeit drehen.

Für höhere Geschwindigkeiten sind es drei Schritte.

Ein einzelner Schritt resultiert immer in der niedrigsten Geschwindigkeit. Details kannst du direkt in der Dokumentation des Autoren erfahren. Siehe [4].

**3.1. Automatische Bauteile Bestimmung**

1. Erkennung von NPN und PNP bipolaren Transistoren, N- und P-Channel MOSFETs, JFETs, Dioden, Doppeldioden, N- und P-IGBTs, Thyristoren und Triacs. Für Thyristoren und Triacs müssen die Zünd- und Halteströme für die richtige Erkennung erreicht werden können. Bei IGBTs muß die Gate Schwellwertspannung unter  $5V$  liegen.
2. Darstellung der Pin-Belegung der erkannten Bauteile.
3. Messung des Stromverstärkungsfaktors und der Basis-Emitter-Schwellspannung für bipolare Transistoren.
4. Darlington-Transistoren können durch die höhere Schwellspannung und durch den hohen Stromverstärkungsfaktor erkannt werden.
5. Automatische Erkennung einer Schutzdiode bei bipolaren Transistoren und bei MOSFETs.
6. Messung der Schwellwert-Spannung, der Gate-Kapazität und des  $R_{DSON}$  bei einer Gate-Spannung von knapp  $5V$  von MOSFETs.
7. Bis zu zwei Widerstände werden gemessen und mit den -Symbolen und den Widerstandswerten mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt. Alle Symbole werden eingerahmt mit den gefundenen Testpin Nummern des Testers (1-3). Deshalb können auch Potentiometer gemessen werden. Wenn der Schleifer eines Potentiometers auf eine Endposition gestellt ist, kann der Tester nicht mehr zwischen mittlerem Anschluss und Endanschluss unterscheiden.
8. Die Auflösung der Widerstandsmessung ist jetzt bis zu  $0,01\Omega$ , Werte von bis zu  $50M\Omega$  werden erkannt.
9. Ein Kondensator kann erkannt und gemessen werden. Der wird mit dem Symbol  und dem Kapazitätswert mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt. Der Wert kann zwischen  $25pF$  (bei  $8MHz$  Takt,  $50pF$  bei  $1MHz$  Takt) bis  $100mF$  liegen. Die Auflösung kann bis zu  $1pF$  (bei  $8MHz$  Takt) betragen.
10. Bei Kondensatoren mit einer Kapazität über  $20nF$  wird zusätzlich der äquivalente Serienwiderstand (ESR) des Kondensators mit einer Auflösung von  $0,01\Omega$  gemessen und mit zwei Dezimalstellen angezeigt. Diese Fähigkeit steht nur zur Verfügung, wenn der ATmega mindestens 16K Flashspeicher besitzt.
11. Für Kondensatoren mit einem Kapazitätswert über  $5000pF$  kann der Spannungsverlust Vloss nach einem Ladepuls bestimmt werden. Der Spannungsverlust gibt einen Hinweis auf die Güte des Kondensators.
12. Bis zu zwei Dioden werden mit dem Symbol  oder dem Symbol  in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Zusätzlich werden die Schwellspannungen angezeigt.
13. Eine LED wird als Diode erkannt, die Schwellspannung ist viel höher als bei einer normalen Diode. Doppeldioden werden als zwei Dioden erkannt.
14. Zener-Dioden können erkannt werden, wenn die Zener-Spannung unter  $4,5V$  ist. Sie werden als zwei Dioden angezeigt, man kann das Bauelement nur mit den Spannungen erkennen. Die äußeren Testpin-Nummern, welche die Dioden Symbole umgeben, sind in diesem Fall identisch. Man kann die wirkliche Anode der Diode nur durch diejenige Diode herausfinden, deren Schwellwert-Spannung nahe bei  $700mV$  liegt!
15. Wenn mehr als 3 Dioden erkannt werden, wird die gefundene Anzahl der Dioden zusammen mit der Fehlermeldung angezeigt. Das kann nur passieren, wenn Dioden an alle drei Test-

- Pins angeschlossen sind und wenigstens eine Zener-Diode ist. In diesem Fall sollte man nur zwei Test-Pins anschließen und die Messung erneut starten, eine Diode nach der anderen.
16. Der Kapazitätswert einer einzelnen Diode in Sperr-Richtung wird automatisch ermittelt. Bipolare Transistoren können auch untersucht werden, wenn nur die Basis und entweder Kollektor oder Emitter angeschlossen wird.
  17. Die Anschlüsse einer Gleichrichter-Brücke können mit nur einer Messung herausgefunden werden.
  18. Kondensatoren mit Kapazitätswerten von unter  $25pF$  werden normalerweise nicht erkannt, aber sie können zusammen mit einer parallel geschalteten Diode oder mit einem parallel geschaltetem Kondensator mit wenigstens  $25pF$  gemessen werden. In diesem Fall muss der Kapazitätswert des parallel geschalteten Bauteils vom Messergebnis abgezogen werden. Bei Prozessoren mit mindestens 32K Flash Speicher wechselt der Tester mit einem Kondensator  $> 25pF$  an TP1 und TP3 in eine Kondensator-Meßfunktion, die auch Kapazitäten ab  $1pF$  direkt mißt.
  19. Bei Widerständen unter  $2100\Omega$  wird auch eine Induktivitätsmessung durchgeführt. Dabei wird zusätzlich zum Widerstands-Symbol  ein Induktivitäts Symbol  angezeigt. Der Anzeigebereich ist etwa  $0,01mH$  bis über  $20H$ , die Genauigkeit ist allerdings nicht hoch. Das Ergebnis wird nur bei einem Einzelwiderstand zusammen mit dem Widerstandswert angezeigt.
  20. Die Messzeit beträgt ungefähr zwei Sekunden, nur Kapazitätsmessungen und Induktivitätsmessungen können länger dauern.
  21. Die Software kann für Messerien mit vorgebarer Wiederhol-Zahl konfiguriert werden, bevor die automatische Abschaltung ausschaltet.
  22. Eingebaute Selbsttest-Funktion inklusive einem optionalen  $50Hz$  Frequenz-Generator um die Genauigkeit der Taktfrequenz und der Verzögerungszeiten zu überprüfen.
  23. Wählbare Möglichkeit den Nullabgleich für die Kondensatormessung und die Innenwiderstände für die Portausgänge beim Selbsttest automatisch zu bestimmen. Ein externer Kondensator mit einer Kapazität zwischen  $100nF$  und  $20\mu F$  an Pin 1 und Pin 3 ist notwendig, um die Offset-Spannung des analogen Komparators zu kompensieren. Dies kann den Messfehler bei Kapazitätsmessungen bis zu  $40\mu F$  reduzieren. Mit dem gleichen Kondensator wird eine Korrekturspannung zum Einstellen der richtigen Verstärkung für die ADC Messung mit der internen  $1,1V$  Referenzspannung berechnet.
  24. Anzeige des Kollektor-Emitter-Reststroms  $I_{CE0}$  mit stromloser Basis ( $1\mu A$  Auflösung) und des Kollektor-Emitter Reststroms  $I_{CES}$  mit der Basis auf Emitter-Potential gehalten. Diese Werte werden nur angezeigt, wenn sie nicht Null sind (besonders für Germanium-Transistoren).
  25. Der Tester wechselt vom Multifunktionstest zu einem Modus als Widerstands-Meßgerät, wenn bei der automatischen Bauteile-Erkennung nur ein Widerstand an Test Pin 1 (TP1) und Test Pin 3 (TP3) erkannt wird. Wenn in der Makefile auch die Induktivitätsmessung beim Widerstandsmeßgerät mit der Option `RMETER_WITH_L` gewünscht wurde, werden bei der Widerstandsmessung auch Induktivitäten gemessen. Der Betriebsmodus wird durch **[R]** oder **[RL]** auf der rechten Seite von Zeile 1 des Displays angezeigt. Genau so wechselt der Tester zu einem Kapazitätsmeßgerät, wenn bei der Bauteile-Untersuchung eine Kondensator an TP1 und TP3 erkannt wurde. Dieser Betriebsmodus wird durch **[C]** auf der rechten Seite der Zeile 1 angezeigt. In dieser Betriebsart können Kondensatoren ab  $1pF$  gemessen werden. Lediglich für den automatischen Start der Funktion braucht man einen Kondensator mit mehr als  $25pF$ . Beide Sonderfunktionen können durch einen Tastendruck wieder beendet werden. Der Tester fährt dann mit der normalen Meßfunktion fort.
  26. Es kann eine Dialogfunktion gewählt werden, die weitere Einsatzmöglichkeiten zugänglich machen kann. Natürlich kann über den Dialog auch zu der Transistortester-Funktion zurückgekehrt werden.

27. Mit Dialogfunktion kann am PD4-Port des ATmega eine Frequenzmessung vorgenommen werden. Die Auflösung beträgt bei Eingangsfrequenzen über  $33kHz$  ein Hertz. Bei niedrigeren Frequenzen kann die Auflösung bis zu  $0,001mHz$  betragen.
28. Mit Dialogfunktion und ohne serielle Ausgabe kann eine externe Spannung bis  $50V$  über einen 10:1 Spannungsteiler am PC3 Pin gemessen werden.
29. Mit Dialogfunktion kann eine Frequenzausgabe auf dem TP2-Pin (PB2-Port des ATmega) erfolgen. Derzeit können von Frequenzen von  $1Hz$  bis  $2MHz$  eingestellt werden.
30. Mit Dialogfunktion kann eine feste Frequenz mit einstellbarer Pulsweite auf dem TP2-Pin (PB2-Port des ATmega) ausgegeben werden. Die Breite kann mit kurzem Tastendruck um 1% und mit längerem Tastendruck um 10% erhöht werden.
31. Mit der Dialogfunktion kann eine spezielle Kondensatormessung mit ESR-Messung gestartet werden. Die Funktion wird bei der Auswahl C+ESR@TP1:TP3 genannt. Kapazitäten ab etwa  $2\mu F$  bis zu  $50mF$  können meistens wegen der geringen Messspannung von etwa  $300mV$  im eingebauten Zustand gemessen werden.
32. Es kann der ADC mit der Sampling-Methode so genutzt werden, daß Kondensatoren unter  $100pF$  mit einer Auflösung von  $0.01pF$  gemessen werden können. Mit der gleichen Methode können auch Spulen unter  $2mH$  mit deutlich besserer Auflösung über die Resonanzfrequenz mit einem parallelgeschalteten Kondensator bekannter Größe bestimmt werden.

**3.1.1. Auswahlmenü** bietet weitere Möglichkeiten des Testers. Diese Funktionen sind, je nach der benutzten Version unterschiedlich. Manche Funktionen mit dem gleichen oder ähnlichen Namen, unterscheiden sich im Umfang und Bedienung. Genaue Beschreibung findest du direkt in der jeweiligen Einleitung. Siehe [4].

## 3.2. Wichtige Bemerkungen

Stelle immer sicher, dass **Kondensatoren** vor dem Anschluss an den Tester **entladen** sind! Der Tester könnte sonst beschädigt werden bevor er eingeschaltet ist. Es gibt nur wenig Schutzfunktion der ATmega-Anschlüsse. Besondere Vorsicht ist auch geboten, wenn versucht wird, Bauelemente in einer Schaltung zu messen. Das Gerät sollte in jedem Fall vorher von der Stromspeisung getrennt sein und man sollte sicher sein, dass **keine Restspannung** im Gerät vorhanden ist. Beim Messen kleiner Widerstandswerte muss man besonders auf die Übergangswiderstände achten. Es spielt die Qualität und der Zustand von Steckverbindern eine große Rolle, genau so wie die Widerstandswerte von Messkabeln. Dasselbe gilt auch für die Messung des ESR-Wertes von Kondensatoren. Bei schlechten Anschlusskabeln mit Krokodilklemmen wird so aus einem ESR von  $0,02\Omega$  leicht ein Wert von  $0,61\Omega$ . Wenn möglich sollte man Kabel mit Testklemmen an die drei Testports parallel zu vorhandenen Sockeln fest anschließen (anlöten). Dann braucht der Tester für kleine Kapazitäten nicht jedesmal neu kalibriert werden, wenn mit oder ohne eingesteckte Testkabel gemessen wird. Für die Kalibration des Nullwiderstandes macht es aber im allgemeinen einen Unterschied, ob die Testpins direkt am Sockel oder am Ende der Kabel mit den den Testklemmen verbunden wird. Nur im letzteren Fall ist der Widerstand von Kabel und Klemmen mit kalibriert. Im Zweifelsfall kann man die Kalibration mit dem Kurzschluß am Testsockel durchführen und danach den Widerstand der kurzgeschlossenen Klemmen mit dem Tester messen.

## 3.3. Problemfälle

Bei den Messergebnissen sollten Sie immer im Gedächtnis behalten, dass die Schaltung des Transistortesters für Kleinsignal-Bauelemente ausgelegt ist. Normalerweise beträgt der maximale Messstrom etwa  $6mA$ . Leistungshalbleiter machen oft wegen hoher Restströme Probleme bei der Erkennung oder beim Messen der Sperrschicht-Kapazität. Bei Thyristoren und Triacs werden oft die Zündströme oder die Halteströme nicht erreicht. Deswegen kann es vorkommen, dass ein Thyristor als NPN-Transistor oder Diode erkannt wird. Ebenso ist es möglich, dass ein Thyristor oder Triac gar nicht erkannt wird.

Probleme bei der Erkennung machen auch Halbleiter mit integrierten Widerständen. So

wird die Basis-Emitter-Diode eines BU508D-Transistors wegen eines parallel geschalteten internen  $42\Omega$  Widerstandes nicht erkannt. Folglich kann auch die Transistorfunktion nicht geprüft werden. Probleme bei der Erkennung machen oft auch Darlington-Transistoren höherer Leistung. Hier sind auch oft Basis-Emitter-Widerstände verbaut, welche die Erkennung wegen der hier verwendeten kleinen Messströme erschweren.

### 3.4. Bedienungssprachen

- k brasilianisch
- k dänisch
- deutsch
- k dutch
- dánština
- k englisch
- italienisch
- k litauisch
- k slowakisch
- k slowenisch
- spanisch
- k ungarisch
- k polnisch
- russisch

---

## **Kapitel 4      Funktionsmenü in der k-Version**

---

Normalerweise wird beim Start des Testers für eine Sekunde die Batteriespannung angezeigt. Wenn die Spannung eine Grenze unterschreitet, wird eine Warnung hinter der Batteriespannung ausgegeben. Wenn Sie eine aufladbare 9V-Batterie benutzen, sollten Sie den Akku möglichst bald austauschen oder nachladen. In der zweite Zeile die gemessene Betriebsspannung mit „VCC=x.xxV“ angezeigt.

**4.0.1. Einzelmessung**      Wenn der Tester für Einzelmessung konfiguriert ist (POWER\_OFF-Option), schaltet der Tester nach einer Anzeigzeit von 28 Sekunden (konfigurierbar) wieder automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Während der Anzeigzeit kann aber auch vorzeitig eine neue Messung gestartet werden. Nach der Abschaltung kann natürlich auch wieder eine neue Messung gestartet werden, entweder mit dem gleichen Bauteil oder mit einem anderen Bauteil.

**4.0.2. Dauermessung**      Einen Sonderfall stellt die Konfiguration ohne die automatische Abschaltfunktion dar. Hierfür wird die POWER\_OFF-Option in der Makefile nicht gesetzt. Diese Konfiguration wird normalerweise nur ohne die Transistoren für die Abschaltung benutzt. Es wird stattdessen ein externer Ein-/Aus-Schalter benötigt. Hierbei wiederholt der Tester die Messungen solange, bis ausgeschaltet wird.

**4.0.3. Serienmessung**      In diesem Konfigurationsfall wird der Tester nicht nach einer Messung sondern erst nach einer konfigurierbaren Zahl von Messungen abgeschaltet. Hierfür wird der POWER\_OFF-Option in der Makefile eine Wiederholzahl (z.B. 5) zugewiesen. Im Standardfall wird der Tester nach fünf Messungen ohne erkanntes Bauteil abgeschaltet. Wird ein angeschlossenes Bauteil erkannt, wird erst bei der doppelten Anzahl, also zehn Messungen abgeschaltet. Eine einzige Messung mit nicht erkanntem Bauteil setzt die Zählung für erkannte Bauteile auf Null zurück. Ebenso setzt eine einzige Messung mit erkanntem Bauteil die Zählung für die nicht erkannten Bauteile auf Null zurück. Dies hat zur Folge, dass auch ohne Betätigung des Starttasters immer weiter gemessen werden kann, wenn Bauteile regelmäßig gewechselt werden. Ein Bauteilwechsel führt in der Regel durch die zwischenzeitlich leeren Klemmen zu einer Messung ohne erkanntes Bauteil.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Betriebsmodus für die Anzeigzeit. Wenn beim Einschalten der Starttaster nur kurz gedrückt wurde, beträgt die Anzeigzeit der Messergebnisse nur 5 Sekunden. Wenn der Starttaster bis zum Erscheinen der ersten Meldung festgehalten wurde, beträgt die Anzeigzeit wie bei der Einzelmessung 28 Sekunden. Ein vorzeitiger neuer Messbeginn ist aber während der Anzeigzeit durch erneutes Drücken des Starttasters möglich.

### **4.1. Optionale Menüfunktionen**

Wenn die Menüfunktion eingeschaltet ist, startet der Tester nach einem längeren Tastendruck (> 0.5s) ein Auswahlmenü für zusätzliche Funktionen. Die wählbaren Funktionen erscheinen in Zeile 4 als gekennzeichnete Funktion. Dabei wird die vorige und nächste Funktion in Zeile 3 und 5 angezeigt. Nach einer längeren Wartezeit ohne jegliche Bedienung kehrt das Programm zu der normalen Transistortester-Funktion zurück. Durch kurzen Tastendruck kann zur nächsten Auswahl gewechselt werden. Mit einem längeren Tastendruck startet die angezeigte Zusatzfunktion. Nach Anzeige der letzten Funktion „Schalte aus“ wird wieder die erste Funktion angezeigt.

Die Menü-Auswahl kann auch mit einem schnellen Drehen des Encoders während der Anzeige einer vorausgegangenen Messung aufgerufen werden. Die Menüfunktionen können mit einem

langsamen Drehen des Encoders in beliebiger Richtung ausgewählt werden. Die ausgewählte Menüfunktion kann aber nur mit einem längeren Tastendruck gestartet werden. Innerhalb einer Menüfunktion können Parameter durch eine langsame Drehung des Encoders ausgewählt werden. Eine schnelle Drehung des Encoders kehrt zur Menü-Auswahl zurück.

**4.1.1. Frequenz** -messung benutzt als Eingang den PD4-Pin des ATmega, der auch an das LCD angeschlossen ist. Es wird immer zunächst die Frequenz gemessen, bei Frequenzen unter  $25kHz$  wird auch die mittlere Periode des Eingangssignals bestimmt und daraus die Frequenz mit einer Auflösung von bis zu  $0,001Hz$  berechnet. Bei gesetzter POWER\_OFF-Option in der Makefile wird die Dauer der Frequenzmessung auf 8 Minuten beschränkt. Die Frequenzmessung wird durch Tastendruck beendet und in das Auswahlmenü zurückgekehrt.

**4.1.2. f-Generator** (Frequenz-Generator) hier können die Frequenzen zwischen 1Hz und 2MHz gewählt werden. Die Einstellung der Frequenz kann jeweils nur für die höchste dargestellte Stelle (Ziffernposition) verändert werden. Für die Stellen 1Hz bis 10kHz sind jeweils die Ziffern 0-9 wählbar. Bei der 100kHz Stelle ist 0-20 wählbar. In Spalte 1 der Frequenzzeile wird durch ein > oder < Symbol angezeigt, ob durch einen längeren Tastendruck (> 0.8s) zur höheren oder niedrigeren Stelle geschaltet wird. Zur niedrigeren Stelle (<) kann nur geschaltet werden, wenn die augenblickliche Stelle auf 0 gestellt wurde und wenn nicht die Stelle mit 1Hz Schritten gewählt wurde. Bei der gewählten 100kHz Stelle ist das > Symbol durch ein R Zeichen ersetzt. Der längere Tastendruck bewirkt dann eine Rücksetzung der Frequenz auf den Startwert 1Hz. Bei gesetzter POWER\_OFF-Option in der Makefile muss für den Frequenzwechsel die Taste länger gedrückt werden, da durch einen kurzen Tastendruck (< 0,2s) nur die Zeitüberwachung von 4 Minuten zurückgesetzt wird. Die abgelaufene Zeit wird in Zeile 1 durch einen Punkt für jede abgelaufene 30 Sekunden angezeigt. Durch einen regelmäßigen kurzen Tastendruck kann die vorzeitige Abschaltung der Frequenzerzeugung verhindert werden. Ein längerer Tastendruck (> 2s) kehrt wieder zur Auswahl der Funktionen zurück.

**4.1.3. 10-bit PWM** (Pulsweitenmodulation) hier wird eine feste Frequenz mit einstellbarer Pulsweite an Pin TP2 erzeugt. Mit einem kurzen Tastendruck (< 0,5s) wird die Pulsweite um 1% erhöht, mit einem längeren Tastendruck um 10%. Bei Überschreiten von 99% werden 100% vom erhöhten Wert abgezogen. Bei gesetzter POWER\_OFF-Option in der Makefile wird die Frequenzerzeugung nach 8 Minuten ohne Bedienung beendet. Durch sehr langen Tastendruck (> 1,3s) kann die Frequenzerzeugung auch beendet werden.

**4.1.4. C+ESR@TP1:3** hier wird eine separate Kondensatormessung mit ESR-Messung an TP1 und TP3 gestartet. Messbar sind Kondensatoren mit mehr als  $2\mu F$  bis zu  $50mF$ . Wegen der geringen Messspannung von etwa 300mV sollte in vielen Fällen die Messung in der Schaltung ohne vorherigen Ausbau möglich sein. Bei gesetzter POWER\_OFF-Option in der Makefile ist die Anzahl der Messungen auf 250 beschränkt, kann aber sofort wieder gestartet werden. Die Mess-Serie kann durch einen längeren Tastendruck beendet werden.

**4.1.5. Widerstandsmeßgerät** Mit dem 1--3 Symbol wird der Tester in ein Ohmmeter an TP1 und TP3 verwandelt. Diese Betriebsart wird durch ein [R] in der rechten Ecke der ersten Displayzeile angezeigt. Weil bei dieser Betriebsart die ESR-Meßfunktion nicht benutzt wird, beträgt auch für Widerstände unter  $10\Omega$  die Auflösung nur  $0.1\Omega$ . Wenn die Ohmmeter Funktion mit der Induktivitätsmessung konfiguriert wurde, erscheint hier ein 1---3 Symbol. Dann beinhaltet die Ohmmeter Funktion die Messung von Induktivitäten für Widerstände unter  $2100\Omega$ . In der rechten Ecke der ersten Zeile des Displays wird dann ein [RL] angezeigt. Für Widerstände unter  $10\Omega$  wird dann auch die ESR-Meßmethode benutzt, wenn keine Induktivität festgestellt wurde. Damit erhöht sich die Auflösung für Widerstände unter  $10\Omega$  auf  $0.01\Omega$ . In dieser Betriebsart werden die Meßwerte fortlaufend ermittelt. Mit einem Tastendruck beendet der Tester diese Betriebsart und kehrt wieder zum Menü zurück. Die gleiche Betriebsart wird auch automatisch gestartet, wenn zwischen TP1 und TP3 ein einzelner Wider-

stand angeschlossen wurde und der Start-Taster gedrückt wurde. In diesen Fall kehrt der Tester mit einem Tastendruck wieder zu der normalen Teseterfunktion zurück.

**4.1.6. Kondensatormeßgerät** Mit dem  $1\text{---}||\text{---}3$  Symbol wird der Tester in ein reines Kondensator-Meßgerät an TP1 und TP3 verwandelt. Die Betriebsart wird durch ein [C] in der rechten Ecke der ersten Zeile des Displays angezeigt. Bei dieser Betriebsart können Kondensatoren ab  $1pF$  bis zu  $100mF$  gemessen werden. In dieser Betriebsart werden die Meßwerte fortlaufend ermittelt. Mit einem Tastendruck wird dieser Sonderbetrieb beendet und der Tester kehrt wieder zum Menü zurück. Auch hier wird wie bei der Widerstands-Meßfunktion in den Betriebs-Modus automatisch gewechselt, wenn zwischen TP1 und TP3 ein Kondensator mit der normalen Testerfunktion gemessen wurde. Der Tester kehrt nach dem automatischen Start wieder zu der normalen Testerfunktion zurück, wenn der Taster gedrückt wird.

**4.1.7. Impulsdrehgeber** hier kann ein Drehgeber untersucht werden. Die drei Kontakte des Impulsdrehgebers müssen vor dem Start der Zusatzfunktion beliebig an die drei Testpins des Transistortesters angeschlossen werden. Nach dem Start der Funktion muss der Drehknopf nicht zu schnell gedreht werden. Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen ist, wird die Pinbelegung der Kontakte symbolisch in Zeile 2 dargestellt. Dabei wird der gemeinsame Anschluss herausgefunden und für etwa zwei Sekunden angezeigt, ob an den Raststellung beide Kontakte offen ('o') oder beide Kontakte geschlossen ('C') sind. Ein Impulsdrehgeber mit offenen Kontakten an den Raststellungen wird so mit der Zeile 2 „1-/-2-/-3 o” zwei Sekunden lang angezeigt. Natürlich wird die richtige Pinnummer des gemeinsamen Kontaktes in der Mitte anstelle der '2' angezeigt. Wenn auch die geschlossene Schalterstellung an den Raststellungen vorkommt, wird außerdem in Zeile 2 „1—2—3 C” zwei Sekunden lang angezeigt. Mir ist kein Impulsdrehgeber bekannt, der immer nur geschlossene Kontakte an jeder Raststellung hat. Die Stellungen der Kontakte zwischen den Raststellungen werden nur kurz ( $< 0,5s$ ) ohne die Kennbuchstaben 'o' oder 'C' in Zeile 2 angezeigt. Wenn der Impulsdrehgeber für die Bedienung des Testers eingesetzt werden soll, muß die Makefile Option WITH\_ROTARY\_SWITCH=2 für Drehgeber mit nur den offenen Kontakten ('o') und die Option WITH\_ROTARY\_SWITCH=1 für Drehgeber mit offenen ('o') und geschlossenen ('C') Kontakten an den Raststellungen.

**4.1.8. C ( $\mu F$ )-Korrektur** Mit dieser Menüfunktion kann ein Korrekturwert für die Messung grösserer Kapazitätswerte geändert werden. Die Funktion ist die gleiche, die auch mit der Makefile Option C\_H\_KORR voreingestellt werden kann. Werte über Null reduzieren den Ausgabewert der Kapazität um diesen Prozent Wert, Werte unter Null würden den Ausgabewert anwachsen lassen. Ein kurzer Tastendruck verringert den Korrekturwert um 0.1%, ein längerer Tastendruck vergrößert den Korrekturwert um 0.1%. Ein sehr langer Tastendruck speichert den Wert. Es ist eine Eigenschaft des Meßverfahrens, daß Kondensatoren mit geringer Güte wie Elektrolyt-Kondensatoren mit zu großer Kapazität gemessen werden. Erkennbar ist die Güte über den Parameter Vloss. Gute Kondensatoren haben kein Vloss oder nur 0.1%. Zum Abgleich dieses Parameters sollten also nur Kondensatoren mit über  $50\mu F$  hoher Güte verwendet werden. Übrigens halte ich die Bestimmung des exakten Kapazitätswertes von Elektrolyt-Kondensatoren für überflüssig, da die Kapazität sowohl von der Temperatur als auch der DC-Spannung abhängt.

**4.1.9. Selbsttest** führt ein vollständiger Selbsttest mit Kalibration durch. Dabei werden sowohl die Testfunktionen T1 bis T7 (wenn nicht verhindert mit der Option NO\_TEST\_T1\_T7) als auch die Kalibration mit dem externen Kondensator jedes Mal durchgeführt.

**4.1.10. Spannung** (Spannungsmessung) ist nur möglich, wenn die serielle Ausgabe deaktiviert wurde. Da am Port PC3 ein 10:1-Spannungsteiler vorgesehen ist, können Spannungen bis  $50V$  gemessen werden. Bei gesetzter POWER\_OFF-Option in der Makefile und ohne Bedienung wird die Messung nach 4 Minuten beendet. Die Messung kann aber durch einen besonders langen Tastendruck ( $> 4$  Sekunden) vorher beendet werden.

**4.1.11. Kontrast** kann mit einem sehr kurzen Tastendruck oder einer Linksdrehung des Impulsdrehgebers verringert werden. Ein längerer Tastendruck oder eine Rechtsdrehung des Impulsdrehgebers vergrößert den Einstellwert. Die Funktion wird beendet und der eingestellte Wert wird permanent in den EEPROM geschrieben, wenn die Taste noch länger gedrückt wird.

**4.1.12. Zeige Daten** zeigt neben der Software-Versionsnummer die Daten des Abgleichs an. Dies sind die Nullwiderstände R0 von Pin 1:3, 2:3 und 1:2 . Außerdem werden die Ausgangswiderstände der Ports zur 5V-Seite (RiHi) und zur 0V Seite (RiLo) angezeigt. Die Nullkapazitätswerte (C0) werden ebenfalls in allen Pinkombinationen angezeigt (1:3, 2:3, 1:2 und 3:1, 3:2 2:1). Danach werden auch die Spannungskorrekturen für die Komparatorspannung (REF\_C) und für die Referenzspannung (REF\_R) angezeigt. Bei Graphikdisplays werden danach noch die verwendeten Symbole für die Bauteile und der Fontsatz angezeigt. Jede Seite wird 15 Sekunden angezeigt. Es kann aber auch durch Tastendruck oder einer Rechtsdrehung des Impulsdrehgebers zur nächsten Seite geblättert werden. Mit einer Linksdrehung des Impulsdrehgebers kann die Ausgabe wiederholt werden oder zur vorigen Seite zurückgeblättert werden.

**4.1.13. Schalte aus** schaltet der Transistortester aus.

**4.1.14. Transistor** (Transistortester) verlässt wieder das Menü und wechselt zu der normalen Transistortester-Funktion zurück.

Bei gesetzter POWER\_OFF-Option in der Makefile sind alle Zusatzfunktionen zeitbeschränkt, damit die Batterie nicht verbraucht wird.

## 4.2. Selbsttest und Kalibration

Wenn die Software mit der Selbsttestfunktion konfiguriert ist, kann der Selbsttest durch einen Kurzschluss aller drei Testports und Drücken der Starttaste eingeleitet werden. Für den Start des Selbsttests muss die Starttaste innerhalb von 2 Sekunden noch einmal gedrückt werden, sonst wird mit einer normalen Messung fortgefahren. Wenn der Tester mit einer Menüfunktion (Option WITH\_MENU) konfiguriert ist, wird der vollständige Selbsttest mit den Tests T1 bis T7 nur bei dem „Selbsttest“ ausgeführt, der als Menüfunktion ausgewählt werden kann. Außerdem wird beim Aufruf über die Menüfunktion der Abgleich mit dem externen Kondensator durchgeführt, sonst nur für den ersten Aufruf. Damit kann der durch die kurzgeschlossenen Testports automatisch gestartete Abgleich schneller durchgeführt werden. Die viermalige Testwiederholung bei T1 bis T7 kann vermieden werden, wenn der Starttaster gedrückt gehalten wird. So kann man uninteressante Tests schnell beenden und sich durch Loslassen des Starttasters interessante Tests viermal wiederholen lassen. Der Test 4 läuft nur automatisch weiter, wenn die Verbindung zwischen den Testports gelöst wird.

Wenn die Funktion AUTO\_CAL in der Makefile gewählt ist, wird beim Selbsttest eine Kalibration der Nullwertes für die Kondensatormessung durchgeführt. Für die Kalibration des Nullwertes für die Kondensatormessung ist wichtig, dass die Verbindung zwischen den Testpins (Kurzschluss) während des Tests 4 wieder gelöst wird! Sie sollten während der Kalibration (nach dem Test 6) weder die Testports noch angeschlossene Kabel berühren. Die Ausrüstung sollte aber die gleiche sein, die später zum Messen verwendet wird. Anderenfalls wird der Nullwert der Kondensatormessung nicht richtig bestimmt. Die Kalibration des Innenwiderstandes der Port-Ausgänge wird mit dieser Option vor jeder Messung durchgeführt.

Bei der Kalibration werden zwei Sonderschritte gemacht, wenn die samplingADC Funktion in der Makefile gewählt wurde (WITH\_SamplingADC = 1). Nach der normalen Bestimmung der Nullwerte der Kapazitätsmessung werden dann auch die Nullwerte mit der Sampling Methode (C0samp) bestimmt. Als letzter Teil der Kalibration wird der Anschluß eines Testkondensators für die Spulenmessung an Pin 1 und Pin 3 angefordert mit der Meldung  $1 \text{---} \text{---} 3 \text{ } 10\text{-}30\text{nF(L)}$ . Der Kapazitätswert sollte hierbei zwischen  $10\text{nF}$  und  $30\text{nF}$  liegen, um eine meßbare Resonanzfrequenz bei der späteren Parallelschaltung mit einer Spule ( $< 2\text{mH}$ ) zu erreichen. Für Spulen mit mehr als  $2\text{mH}$  Induktivität sollte die normale Testfunktion ohne die Parallelschaltung eines Kondensators ausreichen. Ein Parallelschalten des Kondensators sollte hier nicht mehr zu einer

Verbesserung des Meßergebnisses führen.

Nach der Bestimmung der Nullkapazitäten ist der Anschluss eines Kondensators mit einer beliebiger Kapazität zwischen  $100nF$  und  $20\mu F$  an Pin 1 und Pin 3 erforderlich. Dazu wird in Zeile 1 ein  $1 \text{---} \parallel \text{---} 3 > 100nF$  angezeigt. Sie sollten den Kondensator erst nach der Ausgabe der C0 Werte oder nach der Ausgabe dieser Aufforderung anschließen. Mit diesem Kondensator wird die Offset-Spannung des analogen Komparators kompensiert, um genauere Kapazitätswerte ermitteln zu können. Die Verstärkung für ADC-Messungen mit der internen Referenz-Spannung wird ebenfalls mit diesem Kondensator abgeglichen, um bessere Widerstands-Messergebnisse mit der AUTOSCALE\_ADC-Option zu erreichen. Wenn die Menüfunktion beim Tester ausgewählt wurde (Option WITH\_MENU) und der Selbsttest nicht als Menüfunktion gestartet wurde, wird der Abgleich mit dem externen Kondensator nur bei der ersten Kalibration durchgeführt. Die Kalibration mit dem externen Kondensator kann nur wiederholt werden, wenn der Selbsttest als Menüfunktion ausgewählt wird.

Der Nullwert für die ESR-Messung wird als Option ESR\_ZERO in der Makefile vorbesetzt. Mit jedem Selbsttest wird der ESR Nullwert für alle drei Pin-Kombinationen neu bestimmt. Das Verfahren der ESR-Messung wird auch für Widerstände mit Werten unter  $10\Omega$  benutzt um hier eine Auflösung von  $0,01\Omega$  zu erreichen.

---

## Kapitel 5 Funktionsmenü in der m-Version

---

Ein langer Tastendruck beim Einschalten aktiviert den Auto-Hold-Modus. In diesem Modus wartet der Tester nach einer Ausgabe auf einen kurzen Tastendruck, um mit der Bauteilesuche weiter zu machen.

Ansonsten läuft der Tester im kontinuierlichen Modus. Die Auswahl des Modus lässt sich per `config.h` (`UI_AUTOHOLD`) umdrehen.

Nach dem Einschalten wird kurz die Firmwareversion angezeigt. Mit einem sehr langen Tastendruck (2s) beim Einschalten, kannst Du die Abgleich-werte auf ihre Standards zurück setzen.

- Das kann praktisch sein, wenn z.B. der Kontrast vom LCD-Modul so verstellt ist, dass man nichts mehr sieht.

Wenn der Tester ein Problem mit den gespeicherten Abgleich-werten entdeckt ( Problem mit dem EEPROM), zeigt er einen Prüfsummenfehler an und benutzt stattdessen die Standardwerte.

**5.0.1. Bauteilesuche** Nach dem Einschalten sucht Tester automatisch nach Bauteilen.

Im kontinuierlichen Modus wiederholt der Tester die Suche nach einer kurzen Wartepause. Wenn mehrfach hintereinander kein Bauteil gefunden wurde, schaltet sich der Tester aus.

Im Auto-Hold-Modus (durch Cursor signalisiert) führt der Tester einen Suchvorgang aus und wartet dann auf einen Tastendruck bzw. Rechtsdrehung vom Drehencoder bevor er die nächste Suche startet.

Die Wartepause und das automatische Abschalten im kontinuierlichen Modus kann mittels `CYCLE_DELAY` und `CYCLE_MAX` Seite 28 in `config.h` geändert werden.

Für den Auto-Hold-Modus gibt es eine optionale automatische Abschaltung (`POWER_OFF_TIMEOUT`) Seite ??, welche nur während der Bauteilesuche und Ausgabe aktiv ist.

In beiden Modi kannst Du das Hauptmenü aufrufen (siehe weiter unten).

**5.0.2. Batterieüberwachung** Jeder Zyklus der Bauteilesuche beginnt mit der Anzeige der Batteriespannung und des Status (ok, schwach, leer). Bei Unterschreiten der Schwellspannung für eine leere Batterie schaltet sich der Tester aus. Die Batterie wird regelmäßig während des Betriebs überprüft.

Die Standardkonfiguration der Batterieüberwachung ist für eine 9V-Batterie ausgelegt, kann aber an fast jede andere Stromversorgung angepasst werden. Im Abschnitt „power management“ in `config.h` findest Du alle Einstellungen dazu auf Seite ??.

Die Batterieüberwachung kann mittels `BAT_NONE` deaktiviert werden, auf direkte Messung für Batterien mit weniger als 5V per `BAT_DIRECT` konfiguriert werden, oder auf indirekte Messung über einen Spannungsteiler (definiert durch `BAT_R1` und `BAT_R2`) gesetzt werden.

Manche Tester unterstützen zwar eine optionale externe Stromversorgung, aber erlauben keine Überwachung dieser.

In diesem Fall kannst Du per `BAT_EXT_UNMONITORED` Probleme mit dem automatischen Abschalten bei zu niedriger Batteriespannung umgehen.

Bei externer Strom-versorgung wird der Batteriestatus dann auf „ext“ (für extern) gesetzt. Die Schwellwerte für eine schwache und leere Batterie werden über `BAT_WEAK` und `BAT_LOW` gesetzt, während `BAT_OFFSET` den Spannungsverlust durch die Schaltung definiert, z.B. Verpolungsschutzdiode und PNP-Transistor zum Schalten der Stromversorgung.

**5.0.3. Ausschalten** Während das Ergebnis der letzten Bauteilesuche angezeigt wird, schaltet ein langer Tastendruck den Tester aus. Dabei zeigt der Tester ein kurzes „Auf Wiedersehen“ oder „Ciao!“ und schaltet sich dann selbst ab. Allerdings bleibt der Tester solange noch eingeschaltet, wie die Taste gedrückt gehalten wird. Das liegt am Design des Schaltungsteils der Stromversorgung.

## 5.1. Menü

Durch zweimaliges kurzes Drücken der Test-Taste nach der Ausgabe des letztes Ergebnisses gelangt man in das Menü. Einfach zweimal kurz hintereinander drücken. Kann vielleicht etwas Übung am Anfang benötigen. ;) Zusätzlich startet auch eine Linksdrehung des Drehcoders das Menü.

Die alte Methode über den Kurzschluss der drei Testpins kann ebenfalls aktiviert werden (UI\_SHORT\_CIRCUIT\_MENU).

Im Menü wählt ein kurzer Tastendruck den nächsten Punkt aus und ein langer Tastendruck führt den ausgewählten Punkt aus. Geht man weiter als der letzte Punkt, gelangt man wieder zum ersten.

Der ausgewählte Punkt mit einem „\*“ davor gekennzeichnet.

Mit dem Drehen wird der vorherige bzw. nächste Punkt ausgewählt. Hier gibt es auch wieder einen Überlauf, d.h. vom ersten zum letzten Punkt.

Ein kurzer Tastendruck führt den Punkt aus, im Gegensatz zu oben.

Manche Punkte/Extras zeigen beim Start das Pin-out der benutzten Testpins kurz an.

Die Info wird für ein paar Sekunden gezeigt, kann aber mit einem kurzen Tastendruck übersprungen werden.

Funktionen, welche Signale erzeugen, geben ihr Signal standardmäßig auf Testpin #2 aus. Dabei werden die Pins #1 und #3 auf Masse gesetzt.

**5.1.1. PWM-Generator** Macht genau das, was Du erwartest ;-) Vor dem Übersetzen der Firmware bitte entweder den PWN-Generator mit einfacher Bedienung oder den mit erweiterter Bedienung auswählen. Letzterer benötigt einen Drehencoder und ein größeres Display. Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: Ausgang (680Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

**5.1.2. Einfache PWM** Zuerst muss man aus einer vorgegeben Liste die Frequenz wählen. Kurzer Tastendruck für die nächste Frequenz und langer Tastendruck zum Starten, wie beim Menü.

Mit Drehencoder ein kurzer Tastendruck zum Starten.

Das Tastverhältnis startet bei 50% und kann in 5%-Schritten geändert werden.

Ein kurzer Tastendruck für +5% und ein langer für -5%.

Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Ist ein Drehencoder vorhanden, lässt sich das Tastverhältnis in 1%-Schritten ändern.

**5.1.3. Erweiterte PWM** Mit einem kurzen Tastendruck schaltest Du zwischen Frequenz und Tastverhältnis um.

Der ausgewählte Wert wird durch ein Sternchen markiert.

Mit dem Dreh-encoder änderst Du den Wert, rechts für höher, links für niedriger.

Und mit einem langen Tastendruck wird auf den Standardwert zurück gestellt (Frequenz: 1kHz, Tastverhältnis: 50%).

Mit zwei kurzen Tastendrücken wird der PWM-Generator beendet.

**5.1.4. Rechteck-Signalgenerator** Der Signalgenerator gibt ein Rechtecksignal mit variabler Frequenz bis zu einem 1/4 des MCU-Taktes aus (2MHz bei 8MHz Takt). Die Startfrequenz liegt bei 1000Hz und kann mit dem Drehencoder geändert werden. Die Dreh- -geschwindigkeit bestimmt den Grad der Änderung, d.h. langsames Drehen ergibt kleine Änderungen und schnelles Drehen große.

Da die Signalerzeugung auf der internen PWM-Funktion der MCU basiert, können nicht beliebige Frequenzen generiert werden, sondern nur in Schritten. Für niedrige Frequenzen ist die Schrittweite recht klein, erst bei hohen Frequenzen wird sie signifikant.

Ein langer Tastendruck stellt die Frequenz zurück auf 1kHz und zwei kurze Tastendrucke beenden den Signalgenerator.

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: Ausgang (680Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

**5.1.5. Voltmeter und Zenertest** Mit Hilfe eines DC-DC-Konverters wird eine Testspannung von bis zu 50V zum Testen von Zenerdioden generiert. Der Anschluss erfolgt über (Vext+). **Solange die Test-Taste gedrückt wird, erzeugt der Konverter die Testspannung und die aktuelle Spannung wird angezeigt.**

Nach dem Loslassen der Taste wird die kleinste gemessene Spannung angezeigt, sofern der Test ausreichend lange für eine stabile Testspannung lief.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Beschaltung für Zenerdiode:

Pin +: Kathode

Pin -: Anode

**5.1.6. ESR-Messung** Die ESR-Messung kann den Kondensator in der Schaltung messen und zeigt neben der Kapazität den ESR an, wenn ein Kondensator tatsächlich entdeckt wird.

**Stelle sicher**, dass der Kondensator **vor dem Anschließen** entladen wurde!

Die gemessenen Werte können von einer Messung außerhalb der Schaltung wegen parallel geschalteter Bauteile abweichen.

Um die Messung zu starten, kurz die Test-Taste drücken.

Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

Beschaltung für Kondensator:

Pin #1: Plus

Pin #3: Minus

**5.1.7. Kondensatorleckstrom** Der Test auf Leckstrom lädt einen Kondensator auf und zeigt dabei den Strom und die Spannung über den Messwiderstand an. Das Laden beginnt mit Rl (680Ω) und schaltet auf Rh (470kΩ) um, sobald der Strom einen bestimmten Grenzwert unterschreitet.

Jeder Testzyklus beginnt mit der Anzeige der Belegung der Testpins.

Nach dem Verbinden des Kondensators startet ein Druck der Testtaste das Laden (oder Rechtsdrehung bei einem Drehencoder).

Ein weiterer Druck beendet das Laden, und der Tester entlädt den Kondensator während die Restspannung angezeigt wird.

Sobald der Entladegrenzwert erreicht ist, startet der Tester einen neuen Testzyklus.

Zum Verlassen des Tests zweimal kurz die Testtaste drücken.

**Hinweis: Auf Polarität von Elkos achten!**

Beschaltung für Kondensator:

Pin #1: Plus

Pin #3: Minus

**5.1.8. R/L-Monitor** Der R/L-Monitor misst ständig Widerstand und ggf. Induktivität eines Bauteils an den Pins #1 und #3. Zwischen den Messungen gibt es jeweils ein kurze Pause von 2 Sekunden, die durch einen Cursor unten rechts signalisiert wird. Während der Pause lässt sich der Monitor durch zwei kurze Tastendrucke (Testtaste) beenden.

**5.1.9. C-Monitor** Der C-Monitor misst ständig Kapazität und ggf. den ESR eines Kondensators an den Pins #1 und #3. Zwischen den Messungen gibt es jeweils ein kurze Pause von 2 Sekunden, die durch einen Cursor unten rechts signalisiert wird. Während der Pause lässt sich der Monitor durch zwei kurze Tastendrucke (Testtaste) beenden.

**5.1.10. Frequenzzähler** Den Frequenzzähler gibt es in zwei Versionen.

Der Einfache besteht aus einem passiven Eingang auf den T0-Pin (F-in) der MCU. Und der Erweiterte hat neben einem Eingangspuffer auch zwei Oszillatoren zum Testen von Quarzen (für niedrige und hohe Frequenzen) und einen zusätzlichen Frequenzvorteiler.

Beide Schaltungen sind in der Dokumentation von Karl-Heinz [?] beschrieben.

**5.1.11. Einfacher Zähler** Ist die Zusatzschaltung für den einfachen Frequenzzähler eingebaut, kannst Du damit Frequenzen von ca. 10Hz bis zu 1/4 der MCU-Taktfrequenz mit einer Auflösung von 1Hz bei Frequenzen unterhalb von 10kHz messen.

Die Frequenz wird ständig gemessen und angezeigt, bis Du die Messung durch zwei kurze Tasten- drücke beendest. Die automatische Bereichswahl setzt die Torzeit auf Werte zwischen 10ms und 1000ms, je nach Frequenz. Der T0-Pin kann parallel zum Ansteuern einer Anzeige verwendet werden.

**5.1.12. Erweiterter Zähler** Der erweiterte Frequenzzähler hat einen zusätzlichen Vorteiler, welcher die Messung höherer Frequenzen erlaubt.

Das theoretische Maximum liegt bei 1/4 des MCU-Taktes multipliziert mit dem Vorteiler (16:1 or 32:1). Die Steuer- signale werden in config\_<mcu>.h definiert, und bitte nicht vergessen, in config.h den korrekten Vorteiler auszuwählen.

Der Signaleingang (gepufferter Eingang, Quarz-Oszillator für niedrige Frequenzen, Quarz-Oszillator für hohe Frequenzen) wird über die Testtaste oder den Drehencoder geändert.

Zwei kurze Tastendrücke beenden den Frequenzzähler.

**5.1.13. Ereigniszähler** Der Ereigniszähler nutzt den T0-Pin wie der Frequenzzähler als festen Eingang und reagiert auf die steigend Flanke eines Signals. Der T0-Pin kann nicht parallel zum Ansteuern einer Anzeige verwendet werden. Eine einfache Eingangsstufe wird empfohlen.

Der Zähler wird über ein kleines Menü gesteuert, welches auch die Zählerwerte anzeigt. Die Menüpunkte werden über einen kurzen Tastendruck ausgewählt, und die Einstellungen über den Drehencoder oder zusätzliche Tasten geändert.

Der erste Menüpunkt ist der Zählermodus:

- Zählen           zähle Zeit und Ereignisse
- Zeit             zähle Ereignisse für eine vorgegebene Zeit
- Ereignisse       zähle Zeit für eine vorgegebene Anzahl von Ereignissen

Der zweite Menüpunkt „n“ ist die Anzahl der Ereignisse. Im Zählermodus „Ereignisse“ wird der Stopwert angezeigt, welcher geändert werden kann. Ein langer Tastendruck stellt den Stopwert auf einen Vorgabewert (100). In anderen Zählermodi ist dieser Menüpunkt blockiert. Der nächste Menüpunkt „t“ ist die Zeitperiode in Sekunden (Vorgabewert: 60s). Gleiches Spiel, nur für den Zeit-Modus. Und der letzte Menüpunkt startet oder stoppt den Zähler über einen langen Tastendruck. Während der Zähler läuft, werden die Anzahl der Ereignisse und die vergangene Zeit jede Sekunde aktualisiert, und nach dem Stoppen die Ergebnisse angezeigt.

Der Grenzwert für die Zeit ist 43200s (12h) und für die Ereignisse  $4 \cdot 10^9$ . Sobald einer der Grenzwerte überschritten wird, stoppt der Zähler automatisch. Der Grenz- oder Stopwert für Ereignisse wird alle 200ms überprüft. Daher ist bei mehr als 5 Ereignissen/s ein Übersteigen des Wertes möglich.

- **Triggerausgang**       kannst Du mit (EVENT\_COUNTER\_TRIGGER\_OUT) optional aktivieren, um ein anderes Gerät über die Testpins zu steuern.

Der Triggerausgang wird während des Zählens auf High gesetzt, was bedeutet: steigende Flanke beim Start und fallende Flanke bei Stop.

Beschaltung für Triggerausgang über die Testpins:

- Pin #1:       Masse
- Pin #2:       Ausgang (680 Ohm Widerstand zur Strombegrenzung)
- Pin #3:       Masse

**5.1.14. Drehencoder** Diese Funktion testet Drehencoder und bestimmt das Pin-out.

Deine Aufgabe ist es, die Testpins an den Drehencoder (A, B, Common) anzuschließen und den Encoder nach rechts (also Uhrzeigersinn) zu drehen.

Der Algorithmus benötigt 4 Grey-Code-Schritte zur Erkennung.

Die Drehrichtung ist wichtig zur Erkennung von A und B, da eine falsche Richtung zur Verdrehung der Pins führen würde.

Wenn ein Drehencoder entdeckt wird, gibt der Tester die Pinbelegung aus und wartet auf einen Tastendruck beim Auto-Hold-Modus oder wartet kurz beim kontinuierlichen Modus.

Zum Beenden die Test-Taste kurz während eines Suchlaufs drücken.

**5.1.15. Kontrast** kann mit einem kurzer Tastendruck erhöht werden, ein langer Druck verkleinert ihn. Ein Drehencoder kann der Kontrastwert ebenfalls ändern.

Zum Beenden die Test-Taste zweimal kurz hintereinander drücken.

**5.1.16. Detektor/Decoder für IR-Fernbedienungen** Diese Funktion erkennt und dekodiert Signale von IR-Fernbedienungen und benötigt ein

IR-Empfängermodul, wie z.B. aus der TSOP-Serie.

Beim Übersetzen der Firmware kannst Du zwischen zwei Anschlussvarianten wählen.

Bei der ersten Variante wird das Moduls mit den normalen Testpins verbunden.

Die zweite Variante ist ein festes Modul, welches mit einem bestimmten MCU-Pin verbunden ist.

Wenn ein bekanntes Protokoll erkannt wird, gibt der Tester das Protokoll, Adresse (sofern verfügbar), Kommando und ggf. zusätzliche Informationen hexadezimal aus.

Das Ausgabeformat ist: <Protokoll> <Datenfeld(er)>

Bei einem defekten Datenpaket wird „?“ als Datenfeld ausgegeben.

Ist das Protokoll unbekannt, zeigt der Tester die Anzahl der Pausen & Pulse und die Dauer des ersten Puls und der ersten Pause in Einheiten von  $50\mu s$  an: ? <Pulse>:<erster Pulse>-<erste Pause>

Wenn die Anzahl der Pulse bei verschiedenen Tasten der Fernbedienung gleich bleibt, ist die Modulation sehr wahrscheinlich PDM oder PWM.

Eine sich ändernde Anzahl von Pulsen weist auf Bi-Phase-Modulation hin.

Zum Beenden die Test-Taste einmal kurz drücken.

Unterstützte Protokolle und ihre Datenfelder:

- JVC <Adresse>:<Kommando>
- Kaseikyo (Japancode, 48 Bit) <Herstellercode>:<System>-<Produkt>:<Funktion>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C6D6 / 12 bits) <Gerätecode>:<Datencode>
- Motorola <Kommando>
- NEC (Standard & Erweitert) <Adresse>:<Kommando> R für Wiederholsequenz
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresse>:<Kommando>
- RC-5 (Standard) <Adresse>:<Kommando>
- RC-6 (Standard) <Adresse>:<Kommando>
- Samsung / Toshiba (32 Bit) <Gerätecode>:<Datencode>
- Sharp <Adresse>:<Kommando>
- Sony SIRC (12, 15 & 20 Bit) 12 & 15: <Kommando>:<Adresse>  
20: <Kommando>:<Adresse>:<Erweitert>

Optionale Protokolle (SW\_IR\_RX\_EXTRA):

- IR60 (SDA2008/MC14497) <Kommando>
- Matsushita (Panasonic MN6014, C5D6 / 11 bits) <Gerätecode>:<Datencode>
- NEC  $\mu$ PD1986C <Datencode>
- RECS80 (Standard & Erweitert) <Adresse>:<Kommando>
- RCA <Adresse>:<Kommando>
- Sanyo (LC7461) <Gerätecode>:<Taste>
- Thomson <Gerät>:<Funktion>

Die Trägerfrequenz vom TSOP IR-Empfängermodul muss nicht genau zur Fernsteuerung passen.

Es verringert sich eigentlich nur die Reichweite, was für unseren Zweck aber kein Problem darstellt.

- IR-Empfängermodul an Testpins

Das IR-Empfängermodul bitte erst im IR-Fernbedienungsdetektor anschließen!

Beschaltung für das TSOP-Modul:

Probe #1: Masse/Gnd

Probe #2: Vs (680Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Probe #3: Data/Out

Hinweis: Der Widerstand zur Strombegrenzung setzt ein IR-Empfängermodul mit einem Versorgungsspannungsbereich von ca. 2,5 - 5V voraus.

Wenn Du ein 5V-Modul hast, kannst Du in config.h den Widerstand auf eigene Gefahr abschalten. Ein Kurzschluss kann allerdings die MCU zerstören.

- Festes IR-Empfängermodul

Für das feste Modul bitte Port und Daten-Pin in config\_<MCU>.h passend setzen.

**5.1.17. IR-Fernbedienung** Die IR-Fernbedienung sendet Fernbedienungs-codes, welche Du zuvor eingegeben hast, und dient zum Testen von IR-Empfängern bzw. von Geräten mit IR-Fernbedienung.

Diese Funktion benötigt eine zusätzliche Eingabeoption, wie z.B. ein Drehencoder, ein Display mit mehr als vier Textzeilen und eine einfache Treiberschaltung für die IR-LED.

Der Tester zeigt Dir das Protokoll, die Trägerfrequenz, das Tastverhältnis des Trägers und ein paar Datenfelder.

Mit einem kurzen Druck der Test-Taste schaltest Du zwischen den Punkten hin und her.

Der ausgewählte Punkt wird durch ein „\*“ gekennzeichnet.

Über den Drehencoder (oder andere Eingabeoption) änderst Du die Einstellung bzw. den Wert eines Punktes.

Bei einem langen Druck der Test-Taste sendet der Tester den IR-Code solange die Test-Taste gedrückt bleibt. Und wie üblich beenden zwei kurze Tastendrücke die Funktion.

Wenn Du das Protokoll änderst, werden Trägerfrequenz und Tastverhältnis auf die Standardwerte des jeweiligen Protokolls gesetzt.

Du kannst diese aber nach Belieben ändern.

Die Trägerfrequenz kann auf 30 bis 56 kHz gestellt werden, und das Tastverhältnis auf 1/2 (50%), 1/3 (33%) oder 1/4 (25%).

Die Datenfelder sind die Teile des Fernbedienungs-codes, die Du setzen kannst.

Sie werden weiter unten erklärt und sind meistens nur die Adresse und das Kommando.

Unterstützte Protokolle und ihre Datenfelder:

- JVC <Adresse:8> <Kommando:8>
- Kaseikyo (Japanese Code) <Hersteller:16> <System:4> <Produkt:8> <Funktion:8>
- Matsushita (Panasonic, MN6014 12 bits) <Gerät:6> <Taste:6>
- Motorola <Kommando:9>
- NEC Standard <Adresse:8> <Kommando:8>
- NEC Extended <Adresse:16> <Kommando:8>
- Proton / Mitsubishi (M50560) <Adresse:8> <Kommando:8>
- RC-5 Standard <Adresse:5> <Kommando:6>
- RC-6 Standard, Mode 0 <Adresse:8> <Kommando:8>
- Samsung / Toshiba (32 bits) <Gerät:8> <Taste:8>
- Sharp / Denon <Adresse:5> <Kommando:8> <Maskierung:1>
- Sony SIRC-12 <Kommando:7> <Adresse:5>
- Sony SIRC-15 <Kommando:7> <Adresse:8>
- Sony SIRC-20 <Kommando:7> <Adresse:5> <Erweitert:8>

Optionale Protokolle (SW\_IR\_RX\_EXTRA):

- Thomson <Gerät:4> <Funktion:7>

Die Datenfelder sind durch Leerzeichen getrennt und ihre Syntax ist: <Feldname>:<Anzahl Bits>

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: Ausgang (680 $\Omega$  Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

Der Signalausgang (Test-Pin #2) hat einen Widerstand zur Strombegrenzung und kann eine IR-LED mit nur etwa 5mA direkt schalten, was für eine typische IR-LED mit einem  $I_f$  von 100mA nicht ausreichend ist.

Daher wird ein einfacher Treiber auf Basis eines Transistors, der IR-LED und einem Widerstand zur Strombegrenzung benötigt.

Die Abbildung 5.1 zeigt einen Treiber, welcher die IR-LED ( $V_f$  1.5V,  $I_f$  100mA) mit 50mA schaltet.

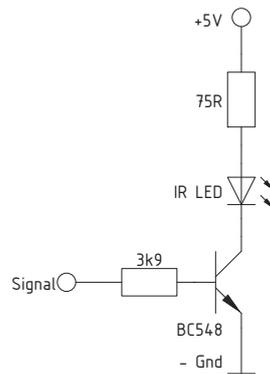


Abbildung 5.1. Beispiel 50mA IR Treiber mit ( $V_f$  1.5V,  $I_f$  100mA,)

Hinweis: Falls das Timing der Pulse/Pausen nicht passen sollte, bitte die alternative Warteschleifenmethode `SW_IR_TX_ALTDELAY` aktivieren.

Dies ist notwendig, wenn der C-Compiler die Standardwarteschleife trotz Anweisung, den Inline-Assembler-Code beizubehalten, optimiert.

**5.1.18. Opto-Koppler-Test** Dieser Test prüft Opto-Koppler und gibt  $V_f$  der LED, den CTR-Wert (auch  $I_f$ ) und  $t_{on}$  bzw.  $t_{off}$  Zeiten (für Transistortypen) aus.

Unterstützt werden Standard-NPN-Transistoren, NPN-Darlington-Stufen und TRIACs. Für die CTR-Messung wird der I/O-Pin der MCU kurzzeitig für ca. 3ms überlastet.

Das Datenblatt gibt einen maximalen Ausgangsstrom vom 20mA an, wir überlasten den Pin aber bis zu ca. 100mA.

Daher ist der maximale CTR-Wert begrenzt, und Werte über 2000% sollte man mit Vorsicht genießen.

Der maximale Strom für die LED ist 5mA, was bei TRIAC-Typen zu beachten ist. Relais-Typen (MOSFET back to back) werden als Transistor erkannt und der CTR-Wert ist dann bedeutungslos. Typen mit anti-parallelen LEDs werden ignoriert.

Zum Testen brauchst Du einen einfachen Adapter mit folgenden drei Testpunkten:

Transistor-Typ:

- Anode der LED
- Kathode der LED und Emitter vom Transistor miteinander verbunden
- Kollektor vom Transistor

TRIAC-Typ:

- Anode der LED
- Kathode der LED und MT1 vom TRIAC miteinander verbunden
- MT1 vom TRIAC

Du kannst den Adapter nach Belieben mit den drei Testpins vom Tester verbinden.

Der Tester findet die Anschlussbelegung dann automatisch.

Nach dem Starten bitte den Adapter mit den Testpins vom Tester verbinden und kurz die Taste zum Prüfen drücken.

Wenn ein Opto-Koppler gefunden wurde, zeigt der Tester den Typen und verschiedene Infos an.

Wurde keiner erkannt, erfolgt die Anzeige von „keiner“.

Ein blinkender Cursor weist darauf hin, dass ein Tastendruck für die nächste Prüfung erwartet wird.

Zwei kurze Tastendrucke beenden, wie üblich, den Test.

**5.1.19. Modellbau-Servo-Test** Diese Funktion erzeugt ein PWM-Signal für Modellbau-Servos, welche mit einem 1-2 ms PWM-Puls gesteuert werden.

Die typischen PWM-Frequenzen von 50, 125, 250 und 333Hz werden unterstützt, und die Pulselänge ist im Bereich von 0,5 bis 2,5 ms einstellbar.

Zusätzlich gibt es einen Sweep-Modus für Pulse von 1 - 2ms und wählbarer Geschwindigkeit. Die Pulsbreite stellst Du mit dem Drehencoder ein. Links für kürzere Pulse, und rechts für längere.

Mit einem langen Tastendruck wird die Pulsweite auf 1,5ms zurück gesetzt (mittlere Position vom Servo).

Mit einem kurzen Tastendruck wechselst Du zwischen Puls- und Frequenzwahl (durch ein Sternchen markiert).

In der Frequenzwahl schaltest Du mit dem Drehencoder zwischen den Frequenzen um. Mit einem langen Tastendruck wird der Sweep-Modus ein- bzw. ausgeschaltet (durch ein „<->“ markiert).

Solange der Sweep-Modus eingeschaltet ist, wird die Pulslänge durch die Sweep-Zeit ersetzt, welche mittels dem Drehencoder geändert werden kann.

Wie üblich beenden zwei kurze Tastendrucke die Funktion.

Beschaltung bei Signalausgabe über die Testpins:

Pin #2: PWM-Ausgang (680Ω Widerstand zur Strombegrenzung)

Pin #1 und #3: Masse

Hinweis: Für den Servo benötigst Du eine zusätzliche Stromversorgung.

Hersteller	Pin 1	Pin 2	Pin3
Airtronics	PWM weiss/schwarz	Gnd schwarz	Vcc rot
Futaba	PWM weiss	Vcc rot	Gnd schwarz
hitec	PWM gelb	Vcc rot	Gnd schwarz
JR Radios	PWM orange	Vcc rot	Gnd braun

Tabelle 5.1. Pinbelegungen für typische 3-Pin-Servo-Stecker

**5.1.20. OneWire-Scan** Der OneWire-Scan zeigt die ROM-Codes all angeschlossenen Busteilnehmer an. Bei Benutzung informiert der Tester über die Beschaltung der Test-Pins und wartet bis ein externer Pull-Up-Widerstand erkannt wurde.

Mit einem Tastendruck lässt sich dies überspringen.

Bei jedem Tastendruck sucht der Tester nach dem nächsten Busteilnehmer und gibt dessen ROM-Code (in hexadezimal) aus.

Der erste Teil der Ausgabe ist der Familiencode und der zweite die Seriennummer.

Der CRC-Wert wird weggelassen. Bei einem Familiencode  $\geq 0x80$  (Bit 7 gesetzt) handelt es sich um einen kundenspezifischen Code, und die oberen (linken) drei Stellen der Seriennummer sind die Kunden-ID.

Der Tester informiert Dich, wenn er den letzten Busteilnehmer gefunden hat, bzw. bei CRC- oder Busfehlern. Im Fall des letzten Busteilnehmers oder eines Busfehlers kannst Du per Tastendruck einen komplett neuen Scandurchlauf starten. Anschluß siehe Seite 24.

Wie üblich beenden zwei kurze Tastendrucke die Funktion.

**5.1.21. Temperatursensor DS18B20** wird hiermit ausgelesen.

Bei Benutzung des OneWire-sensor, informiert der Tester über die Beschaltung der Test-Pins und wartet bis ein externer Pull-Up-Widerstand erkannt wurde.

Mit einem Tastendruck lässt sich dies überspringen.  
Nach dem Verbinden des DS18B20 als einziger Client am Bus startet ein Tastendruck das Auslesen der Temperatur (kann fast eine Sekunde dauern).  
Die Beschaltung für den DS18B20 Sensor ist gleich, wie für OneWire-Scan:

- Probe #1: Masse/Gnd
- Probe #2: VSS (680Ω Widerstand zur Strombegrenzung)
- Probe #3: Data/In

Hinweis: Parallel zum Sensor muss noch ein (4,7kΩ Widerstand zwischen #2 (VSS) und #3 (Data/In) eingesetzt werden.  
Zum Beenden zweimal kurz die Test-Taste drücken.

### 5.1.22. DHTxx-Sensoren

Zum Lesen von DHT11, DHT22 und kompatiblen Temperatur & Luftfeuchte-Sensoren.

Zuerst zeigt der Tester die Beschaltung der Test-Pins und wartet auf den externen Pull-Up-Widerstand.

Danach wird der ausgewählte Sensortyp angezeigt (Standard: DHT11), welcher durch einen kurzen Druck der Testtaste gelesen wird.

Bei erfolgreichem Lesen gibt der Tester die Messwerte aus, bei einem Fehler nur ein ".

Ein langer Tastendruck ändert den Sensortypen, und zwei kurze Tastendrucke beenden die Funktion. Beim Ändern des Sensortyps hast Du die Möglichkeit, den automatischen Lesemodus (jede Sekunde) zu aktivieren. Dieser wird durch ein "\*" nach dem Sensornamen signalisiert.

Unterstützte Sensoren:

- DHT11: DHT11, RHT01
- DHT22: DHT22, RHT03, AM2302
- DHT21, RHT02, AM2301, HM2301
- DHT33, RHT04, AM2303
- DHT44, RHT05

Beschaltung von Test-Pins:

- Probe #1: Gnd
- Probe #2: Data
- Probe #3: Vdd (Strom nicht begrenzt)

Ein externer Pull-Up-Widerstand von 4,7kΩ zwischen Data und Vdd wird benötigt! Manche Sensormodule haben bereits einen 10kΩ Pull-Up-Widerstand integriert, welcher ebenfalls gut mit kürzeren Kabeln funktioniert.

Hinweis:

Wegen des Strombedarfs des Sensor kann der 680 Ohm Testwiderstand nicht zur Strombegrenzung genutzt werden. Also Vorsicht, ein Kurzschluss kann die MCU beschädigen.

### 5.1.23. Selbsttest

Wenn Du den Selbsttest über das Menü gestartet hast, bittet dich der Tester die drei Testpins kurz zu schließen und wartet solange, bis er dies erkennt.

Bei Problemen kannst Du das Warten mit einem Tastendruck abbrechen.

Der Selbsttest führt jeden Test 5-mal aus.

Mit einem kurzen Tastendruck wird der aktuelle Test übersprungen, mit einem langen Tastendruck der komplette Test.

In Test #4 ist der Kurzschluss wieder zu entfernen. Der Tester wartet dann so lange.

Die Testschritte sind:

- T1 interne Spannungsreferenz (in mV)
- T2 Vergleich der Rl-Widerstände (Offset in mV)
- T3 Vergleich der Rh-Widerstände (Offset in mV)
- T4 Entfernen des Kurzschlusses der Testpins/kabel
- T5 Leckstromtest für Testpins mit Gnd-Pegel (Spannung in mV)
- T6 Leckstromtest für Testpins mit Vcc-Pegel (Spannung in mV)

**5.1.24. Selbstabgleich** Der Selbstabgleich misst den Widerstand und die Kapazität der Messkabel, d.h. von Platine, interner Verkabelung und dem Messkabel als Summe, um einen Nulloffset zu bestimmen. Auch wird der interne Widerstand der MCU-Portpins im Pull-Up und Pull-Down Modus bestimmt. Wenn der Abgleich übersprungen wird oder unplausible Werte gemessen werden, werden die Standardwerte der Firmware angenommen.

Wenn alles sauber durch läuft, werden die neuen Werte angezeigt, aber **nicht** im EEPROM gespeichert (siehe Speichern).

Der Spannungsoffset des Analogkomparators wird automatisch bei der Messung eines Kondensators bestimmt (bei der normalen Bauteilesuche), wenn der Kondensator einen Wert zwischen 100nF und 3,3 $\mu$ F hat.

Außerdem wird gleichzeitig der Offset der internen Spannungsreferenz gemessen. Bevor der Selbstabgleich ausgeführt wird, solltest Du einen Folienkondensator mit einer Kapazität zwischen 100nF und 3,3 $\mu$ F min. 3-mal messen, damit die oben erwähnten Offsets bestimmt werden können.

Typischerweise liefert die erste Messung einen zu niedrigen Wert, die zweite einen zu hohen und erst die dritte einen korrekten Wert.

Das wird durch die sich selbst abgleichenden Offsets verursacht. Mit einem festen Kondensator zum Selbstabgleich wird der automatische Abgleich in der Kapazitätsmessung durch eine eigene Funktion ersetzt, welche während des Selbstabgleichs ausgeführt wird.

Somit brauchst Du nicht mehr vorher einen Folienkondensator zu messen. Falls der Kapazitätsoffset zwischen den Test-Pin-Paaren zu sehr variiert, kannst Du in config.h auf Test-Pin spezifische Offsets umschalten ( CAP\_MULTIOFFSET).

Der Selbstabgleich ist dem Selbsttest vom Ablauf und der Bedienung her sehr ähnlich.

Die Schritte des Selbstabgleichs sind:

- A1 Offsets für interne Spannungsreferenz und Analogkomparator  
(nur bei festem Abgleichkondensator)
  - A2 Widerstand der Testpins/Kabel (in 10mOhm)
  - A3 Entfernen des Kurzschlusses der Testpins/Kabel
  - A4 interner Widerstand der Ports-pins für Gnd (Spannung über RiL)
  - A5 interner Widerstand der Ports-pins für Vcc (Spannung über RiH)
  - A6 Kapazität der Testpins/Kabel (in pF)
- Erlaubte Maximalwerte: - Widerstand Testpin/Kabel < 1,50  $\Omega$  (zwei in Reihe)
- Kapazität Testpin/Kabel < 100pF

Hinweis: Wenn der Widerstandswerte der Testpins zu sehr variieren, könnte ein Kontaktproblem vorliegen.

Merke: Abgleich ist nicht Kalibrierung!

Kalibrierung ist die Prozedur, Messergebnisse mit verfolgbaren Standards zu vergleichen und die Abweichungen zu notieren. Der Zweck ist die Überwachung der Abweichungen über die Zeit.

Der Abgleich ist die Prozedur, ein Messgerät so einzustellen, dass es seine Vorgaben bzgl. Genauigkeit und anderer Parameter einhält.

**5.1.25. Speichern/Laden** Beim Brennen der Firmware wird ein Satz vordefinierter Standardwertwerte in das EEPROM geschrieben.

Nach dem Selbstabgleich kannst mit dieser Funktion die Standardwerte durch die korrekten Werte überschreiben.

Beim nächsten Neustart vom Tester werden dann diese Werte (Profil #1) automatisch geladen und benutzt.

Zur Bequemlichkeit stehen zwei Profile zum Speichern bzw. Laden zu Verfügung, z.B. für zwei unterschiedliche Sätze an Messkabeln.

Die Idee hinter der manuellen Speichern-Funktion ist, dass man z.B. beim temporären Wechsel der Messkabel nur einen Selbstabgleich macht und nach dem Neustart wieder die Werte für die Haupt-Messkabel hat.

Ansonsten müsste man für die alten Kabel wieder einen neuen Selbstabgleich machen.

- 5.1.26. Werte anzeigen** Diese Funktion zeigt die aktuellen Abgleich-werte an. Die Nutzung einer externen 2.5V Spannungsreferenz wird mit einem „\*“ nach Vcc signalisiert.
- 5.1.27. Font** Hier kann man alle verwendete Zeichen von installierten Font sehen.
- 5.1.28. Ausschalten** Hiermit kannst Du den Tester abschalten, sofern die Funktion über SW\_POWER\_OFF auf Seite ?? aktiviert wurde
- 5.1.29. Exit** Damit kannst Du das Menü verlassen, wenn Du z.B. aus Versehen reingegangen bist.

Wie schon erwähnt, kann die Firmware an verschiedene Tester und verschiedene Konfigurationen konfiguriert werden.

### 6.1. In der k-Version

konfigurierst du über die Makefile. Da der Entwickler für dieses Tester in einem Ordner Vorkonfiguriert hatte, brauchst du in der Praxis lediglich dein Programmer und Anzeigesprache einstellen. Die Zeile 204 habe ich nur aktiviert, weil der Programmschritt sowieso abläuft. Lediglich die Ausgabe wird unterdrückt:

Software	Original KHK Version 1.13k
Untenordner Name	mega644_hiland_m644
benutzt im FLASH	53.9 %
benutzt im EEPROM	2.2 %
Zeile	Änderung im Makefile
75	UI_LANGUAGE = LANG_GERMAN
190	CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
375	PROGRAMMER=usbasp
376	BitClock=20
377	PORT=usb

Tabelle 6.1. Benutzte k-Software und Modifikation im Makefile

Außerdem wurden mit Erfolg getestet : POLOLU a USBtiny ISP

### 6.2. In der m-Version

sieht die Situation ganz anders aus. Der Entwickler verlässt sich vollständig auf das technische Wissen seiner Unterstützer und ihr Sinn zum Experimentieren.

Als Hilfe dient die Datei Clones.txt, in der die verschiedenen Klone kurz beschrieben werden. Dieser Tester wird dort beispielsweise unter dem Namen Hiland M644 behandelt.

Die Einstellungen sind hier verteilt über die Dateien Makefile, config.h und config<MCU>.h.

### 6.3. Makefile

Im Makefile werden Einstellungen durch das Setzen von bestimmten Variablen durchgeführt. Zum Anpassen einfach den Wert oder die Zeichenkette hinter der Variablen ändern. Für manche Variablen gibt es mehrere Vorschläge, die mittels des #-Symbols auskommentiert sind. Dort bitte die gewünschte Einstellung Einkommentieren (# löschen), und ggf. die Standardeinstellung auskommentieren (# einfügen).

#### 6.3.1. MCU-Typ

```
21 MCU = atmega644
```

Listing 6.1. Worgewählt ist atmega644

#### 6.3.2. MCU-Taktfrequenz

```
28 FREQ = 8
```

Listing 6.2. Worgewählt ist 8MHz

### 6.3.3. Oszillator-Typ

```
34 OSCILLATOR = Crystal
```

Listing 6.3. Worgewählt ist Crystal

### 6.3.4. Avrdude MCU-Typ

```
60 PARTNO = m644p
```

Listing 6.4. Worgewählt ist m644p

### 6.3.5. Avrdude ISP-Programmierer

Bei dem Programmierer sind notwendig:

- Name
- BitClock
- Port

```
62 # avrdude: ISP programmer
63 # choice Buspirate:
64 # PROGRAMMER = buspirate
65 # BITCLOCK=10
66 # PORT = /dev/bus_pirate
67 # choice USBasp Fischl:
68 PROGRAMMER = USBasp
69 BITCLOCK=20
70 PORT = usb
71 # choice USBtiny ISP:
72 # PROGRAMMER = usbtiny
73 # BITCLOCK=5
74 # PORT = usb
75 # choice Pololu:
76 # PROGRAMMER=stk500v2
77 # BITCLOCK=1.0
78 # PORT = /dev/ttyACM0
79 # choice Diamex:
80 # PROGRAMMER = avrispmkII
81 # BITCLOCK=5.0
82 # PORT = usb
```

Listing 6.5. Worgewählt ist USBasp Fischl

Die Liste der Programmer wurde hier schon editiert und einige bekannte Programmer und erprobte Einstellungen zugefügt.

Falls Dein Programmierer nicht aufgeführt ist, bitte die passenden Werte eintragen.

Weitere Informationen findest Du im Avrdude-Handbuch oder der Online-Dokumentation [5].

## 6.4. config.h

Diese Datei dient zum Einstellen von Bedienung und Funktionen. Da es eine normale C-Header-Datei ist, werden die bekannten Kommentar regeln für C verwendet. Um etwas zu aktivieren, ist das //äm Zeilenanfang zu löschen. Zum Deaktivieren wird ein //äm Zeilenanfang eingefügt. Manche Einstellungen benötigen einen Zahlenwert, der ggf. anzupassen ist.

### 6.4.1. Für diesen Tester muss geändert werden:

```
38 #define HW_ENCODER
```

Listing 6.6. Coder Einstellung

```
48 #define ENCODER_PULSES 4
```

Listing 6.7. Anzahl Rastungen für Schritt

```
60 #define ENCODER_STEPS 20
```

Listing 6.8. Anzahl Rastungen für Umdrehung

```
82 #define HW_REF25
```

Listing 6.9. Externe Referenz

```
114 #define HW_ZENER
```

Listing 6.10. Aktivierung von Voltmeter und Z-Dioden

```
123 #define ZENER_HIGH_RES
```

Listing 6.11. Aktivierung von Anzeigegenauigkeit 0,1V

```
159 #define HW_FREQ_COUNTER_EXT
```

```
160 #define FREQ_COUNTER_PRESCALER 16 /* 16:1 */
```

Listing 6.12. Aktivierung von Frequenzzähler

```
175 #define HW_EVENT_COUNTER
```

Listing 6.13. Aktivierung von Ereignisszähler

```
185 #define EVENT_COUNTER_TRIGGER_OUT
```

Listing 6.14. Aktivierung von Triggerausgang

```
206 #define HW_ADJUST_CAP
```

Listing 6.15. Aktivierung von Abgleichskondensator

```
229 //#define SW_PWM_SIMPLE
```

Listing 6.16. Deaktivierung einfachen PWM

```
239 #define SW_PWM_PLUS
```

Listing 6.17. Aktivierung erweiterten PWM

```
247 #define SW_INDUCTOR
```

Listing 6.18. Aktivierung Spulenmessung

```
257 #define SW_ESR
```

Listing 6.19. Aktivierung ESR Messung

```
266 #define SW_ENCODER
```

Listing 6.20. Aktivierung Drehkoder Messung

```
276 #define SW_SQUAREWAVE
```

Listing 6.21. Aktivierung Signal Generator

```
286 //#define SW_IR_RECEIVER
```

Listing 6.22. Deaktivierung IR Empfänger (kein Modul vorhanden)

```
343 #define SW_OPTO_COUPLER
```

Listing 6.23. Aktivation Optokoppler Messung

```
351 #define SW_UJT
```

Listing 6.24. Aktivation SW\_UJT

```
362 #define SW_SERVO
```

Listing 6.25. Aktivation vo Servos testen

```
371 #define SW_DS18B20
```

Listing 6.26. Aktivation von Temperatur Messung

```
381 #define SW_ONEWIRE_SCAN
```

Listing 6.27. Aktivation von OneWire Scan

```
390 #define SW_CAP_LEAKAGE
```

Listing 6.28. Aktivation von Leckstrom Messung bei Elkos

```
399 #define SW_REVERSE_HFE
```

Listing 6.29. Aktivation von messen hFE für BJTs

```
407 #define SW_MONITOR_RL
```

Listing 6.30. Aktivation von RL Aufzeichnung

```
415 #define SW_MONITOR_C
```

Listing 6.31. Aktivation von C Aufzeichnung

```
423 #define SW_DHTXX
```

Listing 6.32. Aktivation DHTxx Feuchte & Temperatur Sensor

```
450 #define NO_HFE_C_RL
```

Listing 6.33. Aktivation des Problemlösung beim Messen

```
493 // #define UI_ENGLISH
```

```
494 #define UI_CZECH
```

Listing 6.34. Deaktivierung von englisch und Aktivieren von deutsch in Zeile 497

```
511 #define UI_COMMA
```

Listing 6.35. Benutzung von Strich statt Punkt

```
528 #define UI_AUTOHOLD
```

Listing 6.36. Aktivierung von Einzelmessung

```
548 #define UI_KEY_HINTS
```

Listing 6.37. Aktivierung Hilfe für Menü

```
596 #define POWER_OFF_TIMEOUT 30
```

Listing 6.38. Automatische Abschaltung nach 30 Sec.

```
606 //#define SW_PROBE_COLORS
```

Listing 6.39. Deaktivierung von Farbkennzeichnung der Testpins

```
614 #define SW_POWER_OFF
```

Listing 6.40. Aktivierung der Volwahl Ausschalten

```
624 #define UI_ROUND_DS18B20
```

Listing 6.41. Aktivierung der Messgenauigkeit auf 0,1 °C

```
634 #define DATA_EEPROM /* store data in EEPROM */
635 #define DATA_FLASH /* store data in Flash */
```

Listing 6.42. Aktivierung von Datenspeichern in Flash

```
932 #define ONEWIRE_PROBES /* via probes */
```

Listing 6.43. Aktivierung des OneWire buses für DS18B20

## 6.5. Config\_644.h

enthält hardwarenahe Einstellungen für Anzeigen, Tasten und so weiter.

Es handelt sich um eine C-Header-Datei, d.h. es gelten die Kommentar-regeln für C. Neben dem “//“ für einzelne Zeilen werden auch Blockkommentare mittels “#if 0 ... #endif“ verwendet. Um einen Block ein kommentieren, einfach ein “//“ vor dem entsprechenden “#if 0“ und “#endif“ einfügen; zum Auskommentieren der umgekehrte Weg. Man kann einen Block auch ein kommentieren, indem man die Zeilen mit dem “#if 0“ und “#endif“ löscht.

### 6.5.1. Notwendige Änderungen

```
145 #if 0
146 #define LCD_ILI9341 /* display controller ILI9341/ILI9342 */
```

Listing 6.44. Aktives ILI9341 deaktiviert

```
168 #endif
```

Listing 6.45. Aktives ILI9341 deaktiviert

```
683 #define POWER_PORT PORTB /* port data register */
684 #define POWER_DDR DDRB /* port data direction register */
685 #define POWER_CTRL PB1 /* controls power (1: on / 0: off) */
```

Listing 6.46. Pinbelegung zur Leistungsregelung

```
703 #define ENCODER_PORT PORTB /* port data register */
704 #define ENCODER_DDR DDRB /* port data direction register */
705 #define ENCODER_PIN PINB /* port input pins register */
706 #define ENCODER_A PB7 /* rotary encoder A signal */
707 #define ENCODER_B PB5 /* rotary encoder B signal */
```

Listing 6.47. Pinbelegung Drehkoder

```
714 #define KEY_PORT PORTB /* port data register */
715 #define KEY_DDR DDRB /* port data direction register */
716 #define KEY_PIN PINB /* port input pins register */
717 #define KEY_INC PB7 /* increase push button (low active) */
718 #define KEY_DEC PB5 /* decrease push button (low active) */
```

Listing 6.48. Pinbelegung für auf/ab Richtung

```

100 // #if 0
101 #define LCD_ST7565R /* display controller ST7565R */
102 #define LCD_GRAPHIC /* graphic display */
103 #define LCD_SPI /* SPI interface */
104 #define LCD_PORT PORTB /* port data register */
105 #define LCD_DDR DDRB /* port data direction register */
106 #define LCD_RESET PB4 /* port pin used for /RES (optional) */
107 // #define LCD_CS PB2 /* port pin used for /CS1 (optional) */
108 #define LCD_A0 PB5 /* port pin used for A0 */
109 #define LCD_SCL PB6 /* port pin used for SCL */
110 #define LCD_SI PB7 /* port pin used for SI (LCD's data input) */
111 #define LCD_DOTS_X 128 /* number of horizontal dots */
112 #define LCD_DOTS_Y 64 /* number of vertical dots */
113 // #define LCD_FLIP_X /* enable horizontal flip */
114 #define LCD_OFFSET_X /* enable x offset of 4 dots */
115 #define LCD_FLIP_Y /* enable vertical flip */
116 #define LCD_START_Y 0 /* start line (0-63) */
117 #define LCD_CONTRAST 3 /* default contrast (0-63) */
118 /* font and symbols: vertically aligned & flipped, bank-wise grouping */
119 // #define FONT_6X8_VF /* 6x8 font */
120 // #define FONT_8X8_VF /* 8x8 font */
121 // #define FONT_8X16_VFP /* 8x16 font */
122 #define FONT_6X8_IS08859_2_VF /* 6x8 Central European font */
123 // #define FONT_8X8_IS08859_2_VF /* 8x8 Central European font */
124 // #define FONT_8X12T_IS08859_2_VFP /* thin 8x12 Central European font */
125 // #define FONT_8X16_IS08859_2_VFP /* 8x16 Central European font */
126 // #define FONT_8X8_WIN1251_VF /* 8x8 cyrillic font */
127 // #define FONT_8X8T_WIN1251_VF /* thin 8x8 cyrillic font */
128 // #define FONT_8X12T_WIN1251_VFP /* thin 9x12 cyrillic font */
129 // #define FONT_8X16_WIN1251_VFP /* 8x16 cyrillic font */
130 #define SYMBOLS_24X24_VFP /* 24x24 symbols */
131 // #define SPI_HARDWARE /* hardware SPI */
132 #define SPI_BITBANG /* bit-bang SPI */
133 #define SPI_PORT LCD_PORT /* SPI port data register */
134 #define SPI_DDR LCD_DDR /* SPI port data direction register */
135 #define SPI_SCK LCD_SCL /* port pin used for SCK */
136 #define SPI_MOSI LCD_SI /* port pin used for MOSI */
137 // #endif

```

Listing 6.49. Deaktiviertes LCD Modul aktiviert und angepasst

**6.5.2. Bemerkung** Einige Einstellungen wurden nur geändert, damit ein Vergleich der Versionen realistisch war.

Software	m-verse 1.39m
Clone Name	Hiland M644
Benutzt FLASH	52 %
Benutzt EEPROM	49,3 %

Tabelle 6.2. Data für aktivierte m-Software

Um die Verzweiflungen und „schlaflose Nächte“, die Schreiber dieses Kapitels erlitten hatte, nach dem er, ohne jegliche AVR Erfahrung, einen Clonetester erworben hatte und diesem die deutsche Sprache „beibringen“ wollte, anderen Kollegen zu ersparen, wurde dieses Kapitel geschrieben.

Die hier bei erworbene Erfahrungen sollten anderen “willigen“ unerfahrenen helfen, ERFOLGREICH ihr Tester zu programmieren.

Diese Gelegenheit wird benutzt, dem Autor und Entwickler des Transistortester

Karl-Heinz Kübbeler siehe [2] zu danken für sein Engagement und Geduld, denn die folgenden Seiten hätten ohne seiner Hilfe nie entstanden.

Damit das übersetzen der Firmware und Brennen ins MCU gelingt und gleichzeitig ... „das Rad nicht neu erfunden sein müsste“, wurde ein Teil der folgenden Seiten aus dem Beschreibung des Transistor Tester von Karl-Heinz Kübbeler siehe [2] übernommen.

Also noch einmal ... **EINEN RIESEN DANK.**

### 7.1. Konfigurieren des Testers

Dazu bitte Kapitel 6 ab Seite 27 lesen.

### 7.2. Programmierung des Mikrocontrollers

Die Programmierung des Testers wird über die Datei Makefile gesteuert.

Die Makefile stellt sicher, dass die Software entsprechend der vorher in der Makefile eingestellten Optionen übersetzt wird.

Das Ergebnis der Übersetzung hat die Dateierweiterung .hex und .eep.

Üblicherweise heißen die Dateien ComponentTester.hex und ComponentTester.eep.

Die .hex-Datei enthält die Daten für den Programmspeicher (Flash) des ATmega-Prozessors.

Die .eep-Datei enthält die Daten für den EEPROM des ATmega.

Beide Dateien müssen in den richtigen Speicher geladen werden.

Zusätzlich muss der ATmega mit den „fuses“ richtig konfiguriert werden.

Wenn Sie das Makefile zusammen mit dem Programm avrdude [5] benutzen, brauchen Sie keine genaue Kenntnis über die Einzelheiten der fuses.

Sie brauchen nur „make fuses“ aufrufen, wenn Sie keinen Quarz benutzen oder Sie müssen „make fuses-crystal“ aufrufen, wenn Sie einen 8MHz Quarz auf der Baugruppe installiert haben.

Wenn Sie sich nicht sicher mit den fuses sind, lassen Sie diese erst einmal wie vom Werk gesetzt und bringen Sie den Tester in diesem Zustand zum Laufen.

Es kann sein, dass das Programm zu langsam läuft, wenn Sie die für den 8MHz-Betrieb erzeugten Programmdateien benutzen, aber das kann man später korrigieren!

Aber falsch gesetzte fuses können die spätere ISP-Programmierung verhindern.

**7.2.1. Betrieb System Linux** Die Programmierung unten Linux bringt viele Vorteile, weil dieses OS von Experten entwickelt wurde, die sich auf den Wünschen der Benutzer orientieren. Zu dem ist die Umgebung kostenlos erhältlich und perfekt gewartet.

Ein weiterer Vorteil ist die Sicherheit von OS selbst aber auch beim nutzen des Internets.

Die heutigen Editionen lassen sich noch viel leichter bedienen als die Mitbewerber OS.

Diese Anleitung soll alle “nicht“ Linux Benutzer dazu animieren es NUN zu testen in dem sie ihr Tester damit programmieren.

Als Beispiel wird hier Linux Mint in der aktueller Version benutzt, die im Internet zu erhalten ist. Die Installation ist auf verschiedene Arten möglich.

### 7.2.2. Benutzung unter Linux auf einem neu installierten OS.

Für diejenigen, die nicht gerne schreiben, bietet Linux eine einfachere Möglichkeit:

Dieses Handbuch auf einen USB-Stick kopieren und im Linux öffnen.

Danach die Maus zum Namen des Dokumentes führen, hier linke Maustaste drücken und das Dokument bis zum linken Rand des Bildschirms ziehen, bis ein möglicher Rahmen angezeigt wird. Nun wird die Maus losgelassen.

Die Anleitung nimmt nun die linke Hälfte des Bildschirms ein.

Im nächsten Schritt wird [Strg] + [Alt] + [t] gleichzeitig gedrückt, um das Befehlsfenster zu öffnen. Dies wird nun auf gleicher Weise nun die rechte Hälfte des Bildschirms belegt.

### 7.2.3. Programm Pakete installieren Nun brauchen wir einen Internetzugang.

Um den Tester zu programmieren, müssen zuerst Programmpakete installiert werden:

'binutils-avr', 'avrdude', 'avr-libc' und 'gcc-avr'.

Jetzt in diesem Dokument zu dieser Seite, bis zu diesem Text navigieren:

```
sudo apt-get install avrdude avr-libc binutils-avr gcc-avr
```

den Text mit gedrückter linken Maustaste markieren, die Maus auf das Cursor des rechten Befehlsfenster führen und durch drücken der mittleren Maustaste (Scroll-Rad) **weiter als [MT] abgekürzt** wieder einfügen.

Nach der Bestätigung mit [Enter], wird von 'sudo' noch Benutzerpasswort verlangt. Anders als bei Windows wird das Passwort **Blind** eingegeben und mit [Enter] bestätigt.

Damit werden nun alle Software Pakete durch 'apt' heruntergeladen und installiert. U.U. muss man dazwischen, Fragen durch [J] bestätigen.

Bitte darauf achten, dass im Linux zwischen Groß und Kleinschreibung unterschieden wird. Also nicht mit [j] sondern mit [J] antworten!

### 7.2.4. Download der Quellen Zum Download der Quellen und der Dokumentation aus dem SVN-Archiv wird das Paket

'subversion' gebraucht. Dies wird erreicht mit einer Anweisung:

```
sudo apt install subversion
```

und nach dem das Paket installiert wurde mit:

```
svn checkout svn://www.mikrocontroller.net/transistortester
```

wird das komplette Archiv heruntergeladen. Wenn Sie dieses Archiv bereits heruntergeladen wurde, werden mit diesem Befehl nur neue Updates heruntergeladen.

Die Dateien sind nun in dem Linux [Persönlicher Ordner] auf (/home/„user“) unten dem Namen „transistortester“.

Die Kontrolle des Vorhandenseins. Terminal Fenster öffnen, „ls“ eingeben und bestätigen.

### 7.2.5. Benutzung der Schnittstellen für den Nutzer (user) vorbereiten.

USB-Geräte können durch Eingabe von 'lsusb' im Befehlsfenster erkannt werden. Geben Sie 'lsusb' zuerst ohne und dann mit angeschlossenem USB-Programmierer ein.

Ein Vergleich der Ergebnisse lokalisiert den USB-Programmierer.

Das Ergebnis von lsusb kann so aussehen:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 058: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
Bus 002 Device 059: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub}
```

Hier wurde als Device 58 ein AVR ISP mkII erkannt (DIAMEX ALL-AVR).

Die ID 03eb ist eine Herstellerkennung und die ID 2104 eine Produktkennung.

Diese beiden Kennungen werden der Datei /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules benötigt und erstellt

mit Hilfe von:

```
sudo xed /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

In diesem Beispiel besteht die Datei 90-atmel.rules aus einer Zeile:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP="plugdev"
```

Dieser Eintrag erlaubt den Zugriff auf das Gerät für Mitglieder der Gruppe „plugdev“.

Um die meisten Programmierer verwenden zu können, wird folgendes Text in 90-atmel.rules empfohlen:

```
# Copy this file to /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
# AVR ISP mkII - DIAMEX ALL-AVR
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="03eb", ATTS {idProduct}=="2104", MODE="0660",
GROUP = "plugdev",
# USB ISP-programmer für Atmel AVR
SUBSYSTEM=="usb", ENV {DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS {idVendor}=="16c0", MODE="0666",
SYSFS {idProduct} == "05dc",
# USB asp programmer
ATTRS {idVendor}=="16c0", ATTRS {idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# USBtiny programmer
ATTRS {idVendor}=="1781", ATTRS {idProduct}=="0c9f", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# Pololu programmer
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS {idVendor}=="1fffb", MODE="0666"
```

Nach dem die Datei erstellt wurde, kann die Erstellung und Inhalt kontrollieren mit:

```
less /etc/udev/rules.d/90-atmel.rules
```

Das ebenfalls als Device 59 erkannte USB Gerät Arduino SA Mega 2560 System erzeugt eine Zugriffsmöglichkeit auf das serielle Gerät „/dev/ttyACM0“ für Mitglieder der Gruppe 'dialout'.

**7.2.6. Gruppen Mitgliedschaft** Deswegen sollte die eigene Benutzererkennung sowohl Mitglied der Gruppe 'plugdev' als auch der Gruppe 'dialout' sein. Das Kommando:

```
sudo usermod -a -G dialout,plugdev $USER
```

sollte die Zugehörigkeit sicherstellen. Jetzt sollte ein Zugriff mit avrdude auf beide Geräte möglich sein. Kontrollieren kann man es mit dem Kommando: 'id'.

Sollten Probleme auftreten kann man die Mitgliedschaft auch über:

Menü/Systemverwaltung/Benutzer und Gruppen/<Passwort>/ nun erscheint ein Fenster mit zwei Reitern.

Wenn man nun im Reiter Benutzer auf sein Name klickt, sieht man rechts sein Profil und die Gruppen Zugehörigkeiten. Mit dem Button <ADD> ist nun Möglich neue Gruppen hinzuzufügen.

**7.2.7. Arbeitsumgebung** getestet mit der m-Version.

Zu erst in der Taskleiste mit grünem Ordnersymbol (Nemo) zum /transistortester/Software/-Markus/ navigieren, mit der rechten Maustaste auf ComponentTester-1.(höchste Nr.)m.tgz klicken, in der Auswahl <hier entpacken> der Ordner Dekomprimieren und Nemo schließen. Damit das Original erhalten bleibt und weil sich das Terminalfenster immer in ../home/ "user" öffnet, wird empfohlen, dort sein Arbeitsverzeichnis mit dem Namen **Mytester** zu verlegen.

Mit der schon bekannten Methode folgendes Verzeichnis markieren, und im Terminal Fenster mir mittlerer Taste einfügen.

```
cd transistortester/Software/Markus/
```

Nach dem Bestätigen und Kommando: 'ls' sieht man alle gepackten Ordner (Endung.tgz) und nur ein Ordner wo diese Endung fehlt -> also unserer (vorher ausgepackter) Ordner.

Bei den folgenden zwei Kommandos, diese zuerst **NUR** einfügen, **ohne [Enter]** zu drücken: !

```
cp -r 'MyT' Mytester/
```

Das Verzeichnis des benötigten Models mit der Maus markieren.

Nun den blinkender Cursor mit Hilfe von [Pfeiltaste-links] zur letztem Zeichen des Text 'MyT' positionieren und diese Zeichen löschen. Nach dem das letzte Zeichen gelöscht wurde, die [MT] Taste der Maus drücken. Erst jetzt [Enter] benutzen. Damit ist die Arbeitsumgebung erstellt. Die Kontrolle der Existenz und Inhalts ist möglich mit:

```
diff 'MyT' Mytester/
```

vobei muss 'MyT', wie vorher, für das Verzeichnis des „benötigten Testers Models“ ausgetauscht werden. Mit dem letzten Anweisung:

In `-s ~/transistortester/Software//Markus/Mytester ~/Mytester`  
wird die Verknüpfung zum Arbeitsverzeichnis erstellt.

Ab jetzt erreicht man dieses Verzeichnis sehr einfach mit:

`[Strg] + [Alt] + [t], cd [Leertaste] My [Tab] [Enter]`

und schon ist man in benötigten Verzeichnis. Mit `'ls'` sieht man den Inhalt.

Weiter geht es zum bearbeiten von Makefile mit, inzwischen bekanntem Anweisung:

`xed Ma [Tab] [Enter]`

**Hier ist am wichtigsten, den VORHANDENEN USB-Programmer anmelden.**  
Siehe dazu im Kapitel 6.3.5, auf der Seite 28, Thema PROGRAMMER.

Folgende Aufrufe sind zu empfehlen:

<code>make clean</code>	zum reinigen des Arbeitsumgebung
<code>make</code>	zum Übersetzen des Programms
<code>make fuses</code>	zum setzen von ATmega „fuses“ ohne Quarz
<code>make fuses-crystal</code>	zum setzen von ATmega „fuses“ NUR mit Version mit <i>8MHz</i> Quarz!
<code>make upload</code>	zum laden des Programms über die ISP Schnittstelle in ATmega

Nun bleibt nur die Freude über das erreichter Erfolg.

**7.2.8. Arbeitsumgebung mit der k-Version** Hier bietet sich an, ein neues Textdokument zu erstellen und hinein den richtigen Pfad einfach von dem Terminal Fenster zu kopieren. Zu dem kannst du in den deine oft benutzte Befehle einschreiben, damit du sie bei der Hand hast. Der Vorgang ist folgend:

Drücke gleichzeitig `[Strg] + [Alt] + [t]` und kopiere dahin folgendes Befehl:  
`xed r-Version.txt [Enter]`

und ein neues Dokument ist erstellt und geöffnet. Hinein kopiere die nächsten Zeilen:

```
cd transistortester/Software/trunk/mega644_hiland_m644/  
xed Makefile  
make clean  
make  
make fuses-crystal  
make upload
```

- Und deine weitere Bemerkungen. Nun musst du es nur auf der Arbeitsfläche speichern.

### 7.3. Nötige Hardware zum Programmieren

Für die Anfänger die noch nichts besitzen gelten die folgende Informationen.

**7.3.1. Programmierer** braucht unten Linux kein Treiber. Du musst ihm lediglich, wie im Teil 7.2.5 und in der Makefile 6.3.5 korrekt einstellen.

Ein großer Vorteil von 'avrdude' ist, das es mit preiswerten Programmer zufrieden ist, der du schon unten 2 Euro bekommst wie zum Beispiel unten 7.3.2 auf dieser Seite.

Weiter benötigt man ein angepasstes Kabel, das man relativ einfach selbst erstellen kann. Bei der Auslieferung ist der Nullkraft-Testsockel über Buchsenleisten mit der Platine verbunden. Siehe das rechte Bild 2.1 auf Seite 5.

Bei dem links abgebildeten Tester, wurde der Sockel direkt angelötet und die hiermit gesparte Buchsenleiste auf ein vorhandenes Kabel angelötet und mit Schrumpfschlauch fixiert.

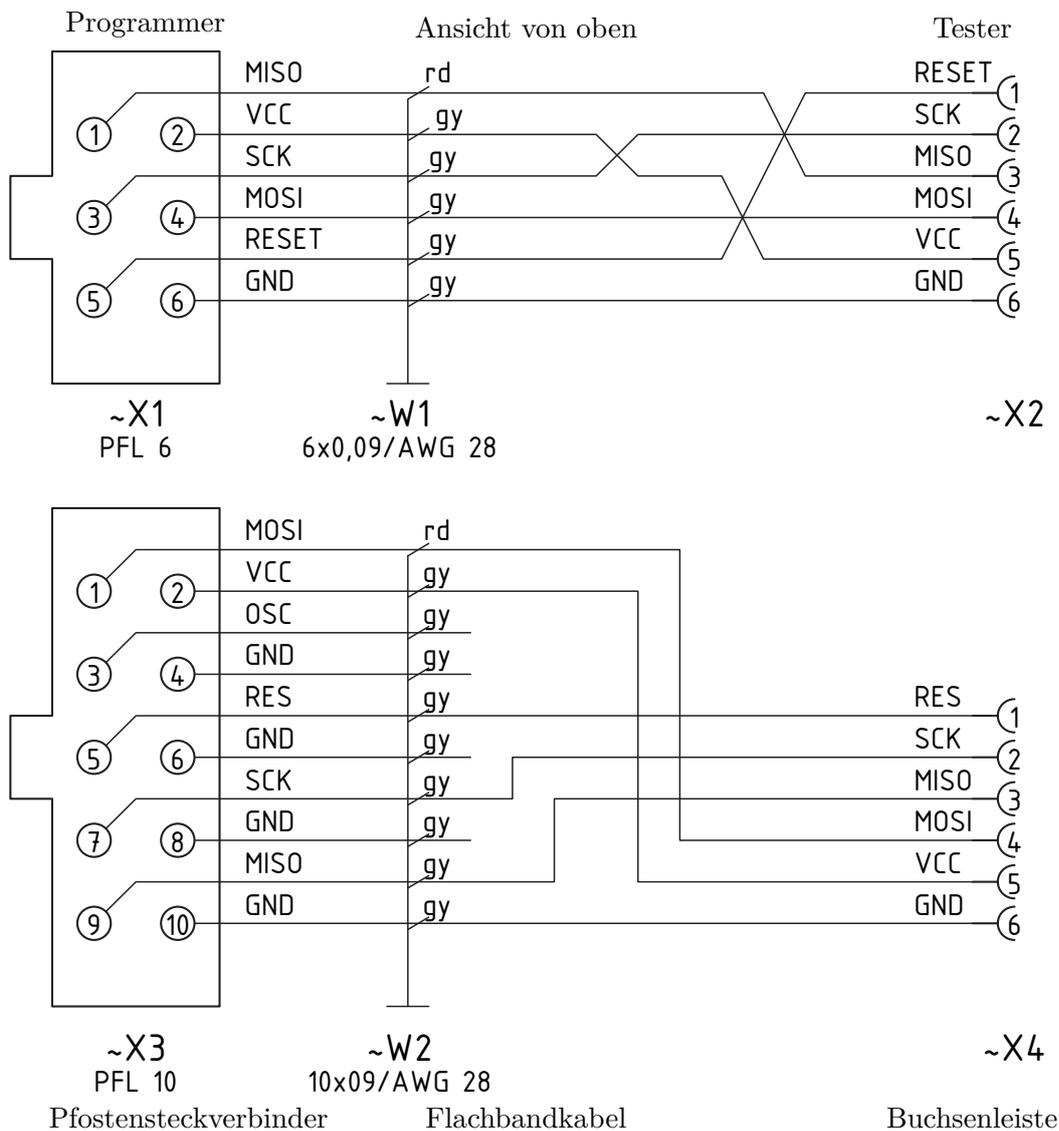


Abbildung 7.1. 6 und 10 pol Kabel für die Programmierung

Mehr ist nicht nötig. ;-)

### 7.3.2. Kauf Möglichkeit

- **Programmer:** Zum Beispiel bei [9].
- **Und, falls du noch kein Tester besitzt:** zum Beispiel [10].

Und nun bist du dran.

## 7.4. Hiland Schaltung mit ATmega644

**Achtung!** Folgende Schema zeigt das Bauteile Schema ohne Garantie der Vollständigkeit. Sie ist nicht Maßstabgerecht.

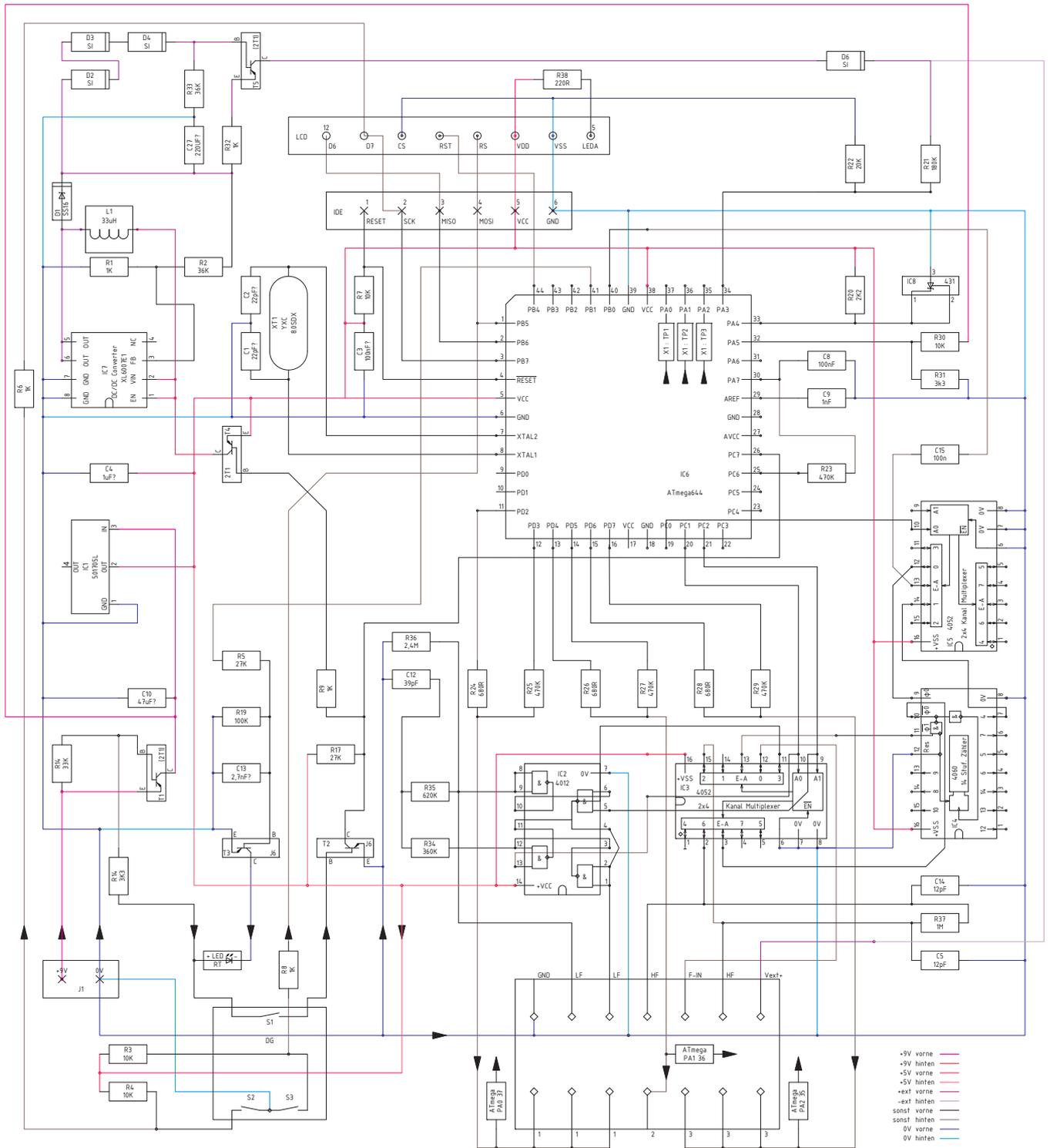


Abbildung 7.2. Transistortester Schaltung mit ATmega644

## 7.5. Technische Daten

Model	Hiland
Grösse	75 x 63 x 35 mm
Bauart	SMD
AVR	ATmega 644PA
Quarz	8 MHz
Anzeige	ST7565-based LCD
IDE möglich	ja
Bedienung	Impulsdrehgeber mit Taster
Spannungsversorgung	9V E-Block
Verbrauch Betrieb	
Verbrauch Standby	20 nA
Messspannung	5V
Messstrom	6 mA
Bestimmung und Messung	Transistoren, MOSFET, JFET, P-IGBT, Dioden,
Bestimmung und Messung	Zenerdioden bis 50V, Thyristoren und Triacs
Bestimmung und Messung	Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Quarzen
Frequenz Messung	1 Hz -
Frequenz Generierung	1 Hz - 2MHz
Generierung von Impulsen	Festfrequenz von 7,8 kHz; Impulsbreite 1% - 99%
Spannungsmessung	0V - 50 V DC
Bereich Widerstände	0,01 -
Bereich Kondensatoren	1pF - 100mF
Bereich Spulen	0,01mH -

Tabelle 7.1. Technische Daten

## 7.6. Hilfe

kannst du im deutschen Forum versuchen [6].

Änglisches Forum erreichst du auf [7]

und fallst du slowakisch beherscht auf [8].

**Und für Entspannung** oder für die Beschäftigung deines Nachwuchs: [11].

---

## *Literaturverzeichnis*

---

- [1] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester>  
*Online Dokumentation des Transistortesters, Online Article, 2009-2011*
- [2] <https://github.com/svn2github/transistortester/blob/master/Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf>  
*Aktuelle Anleitung zum Transistor Tester*
- [3] <https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/Markus>  
*Komplette Software Sammlung 2012-2019*
- [4] <https://github.com/madires/Transistortester-Warehouse>  
*Komplette Software Sammlung 2012-2019*
- [5] <http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE>  
*Online Dokumentation avrdude IDE*  
Online Dokument, 2004-2011
- [6] <https://www.mikrocontroller.net/topic/248078>  
*Hauptsprache ist Deutsch, Englisch ist auch ok.*
- [7] [https://www.eevblog.com/forum/testgear/\(dolarovaznacka\)20-lcr-esr-transistor-checker-project/](https://www.eevblog.com/forum/testgear/(dolarovaznacka)20-lcr-esr-transistor-checker-project/)  
*Nur Englisch.*
- [8] <https://svetelektro.com/> *Všetko zo sveta elektroniky*  
Slowakisches Forum
- [9] <https://www.ebay.de/itm/usbasp-avrisp-usbisp-Programmer-usb-10Pin-Convert-to-6P-Adapter-Board-STK50-AHS/302923364644>  
*Programmer.*
- [10] <https://de.aliexpress.com/item/4000069589587.html>  
*Hiland644 Tester*
- [11] <https://dragoosemchama.com/en/2017/01/rex/>  
*Spiel Tetris für den Tester und weitere Infos*